

修士論文

к 2 к 長基線ニュートリノ振動実験 シンチレータトラッカーにおける 読み出し用エレクトロニクスの開発

京都大学大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 高エネルギー物理学研究室

山本 真平

2003年1月30日

Abstract

本論文は、K2K 長基線ニュートリノ振動実験において我々があらたな前置検出器として導入 するシンチレータトラッカーのための読み出し用エレクトロニクスの開発に関するものである。 K2K は、ニュートリノが質量を持つときにおこるフレーバー間の混合現象であるニュートリ ノ振動の検証を目的とした実験である。高エネルギー加速器研究機構 (KEK)12GeV 陽子シン クロトロンを用いて純粋な ν_μ ビームを生成し、KEK 内に設置された前置検出器、また KEK から 250km 離れた Super-Kamiokande(SK) にてニュートリノエネルギースペクトルの測定を 行う。ニュートリノ振動がある場合、

$$P(\nu_{\mu} \to \nu_{\mu}) = 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \left(1.27 \Delta m^2 [\text{eV}^2] \frac{L[\text{km}]}{E[\text{GeV}]} \right)$$

にて記述される振動確率によって前置検出器での観測に比べて SK で観測されるエネルギー スペクトルに歪みが見えることが期待され、この検証のためには前置検出器での精密なスペ クトル測定が求められる。現在の K2K の振動パラメータに対する解析結果は $\Delta m^2 = 1.5 \sim 3.9 \times 10^{-3} [\text{eV}^2], sin^2 2\theta = 1.0$ 、また 99%C.L. でニュートリノ振動を示唆している。われわれ の目標はニュートリノ振動の確立、また振動パラメータの精密測定であり、そのためには上記 の振動パラメータから期待される、振動に対して感度の高い 0.6GeV 付近の低エネルギーニュー トリノの精密測定が必要である。さらにニュートリノエネルギー再構成には荷電カレント準弾 性散乱反応 $n + \nu_{\mu} \rightarrow p + \mu^{-}$ を用いるが、その事象観測のバックグラウンドとなる π 生成反応 等の詳細な研究が必要である。

我々はこのような動機のもと、新たな前置検出器としてシンチレータトラッカーを開発した。 検出器は低エネルギー粒子の検出効率を上げるためにファインセグメント化され、かつ不感領 域がない。このシグナル読み出しには波長変換ファイバー、また光検出器としては 64ch マル チアノード光電子増倍管を用いる。

わたしはこのシンチレータトラッカーにおける読み出し用エレクトロニクスを開発した。まず 64ch

Contents

1	ニュ	ートリノとその振動	7
	1.1	ニュートリノの発見とその歴史	7
	1.2	ニュートリノ振動とその物理的背景	8
	1.3	ニュートリノ振動の実験的検証	10
		1.3.1 Super-Kamiokande における大気ニュートリノ観測	10
		1.3.2 その他の振動検証実験	13
2	K2ł	K 長基線ニュートリノ振動実験	15
	2.1	実験概要および測定原理..................................	15
		2.1.1 ニュートリノ反応カテゴリ	15
		2.1.2 振動パラメータの測定原理	17
	2.2	ニュートリノビームライン	18
		2.2.1 電磁ホーンシステム	18
		2.2.2 PIMON – <i>π</i> 中間子モニター –	18
		2.2.3 MUMON – ミューオンモニター –	19
	2.3	前置検出器	21
		2.3.1 1kt 水チェレンコフ 検出器	21
		2.3.2 SciFi – シンチレーションファイバー検出器 –	21
		2.3.3 LG – 鉛ガラスカロリメータ –	22
		2.3.4 MRD – ミューオンレンジ検出器 –	22
	2.4	後置検出器 – Super-Kamiokande–	22
	2.5	解析結果....................................	23
3	全感	知型シンチレータ飛跡検出器の導入	29
	3.1	動機	29
	3.2	検出器の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	3.3	本検出器での研究....................................	32
	3.4	実験スケジュール	32
4	シン	チレータトラッカーの読み出し系	33
	4.1	シンチレータトラッカーにおけるシグナルの読み出し...........	33
	4.2	本論文での研究	34
5	8 ×8	3マルチアノード光電子増倍管	37
	5.1	Н7546	37
	5.2	光検出器に課せられる要求.................................	38

	5.3	テストセットアップの構成.................................	39
	5.4	ゲイン曲線およびダークカレント	41
	5.5	パルスリニアリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	5.6	クロストーク率	45
		5.6.1 ファイバー 径の仕様の決定	46
	5.7	チャンネルユニフォーミティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
	5.8	時間分解能	51
	5.9	考察およびまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
	0.0		01
6	VA/	′TA フロントエンドエレクトロニクスの開発	55
	6.1	VA32_HDR11+TA32CG	55
	6.2	VA/TA の入出力信号およびバイアスパラメータ	57
		6.2.1 入出力信号リスト	57
		6.2.2 バイアスパラメータのリスト	57
	6.3	VA/TA の読み出し原理	59
	6.4	VA32_HDR11+TA32CGの性能評価	63
		6.4.1 VA/TA プロトタイプフロントエンドボード	63
		6.4.2 VA/TA フロントエンドエレクトロニクスに課せられる要求	63
		6.4.3 VA のチャンネル間クロストーク	65
		6.4.4 MAPMT と VA の結合形態に関する考察	65
		6.4.5 TA の時間分解能	67
		6.4.6 トリガー検出についての考察	67
	6.5	VA/TA プロトタイプフロントエンドボードを用いたビームテストでの動作評価	70
		6.5.1 テストセットアップ、トリガーロジック	70
		6.5.2 VA による読み出しと charge sensitive ADC によるものとの比較	71
		6.5.3 ノイズについての評価	72
	6.6		76
7	VA/	′TA フロントエンド読み出し用 DAQ module の開発	79
	7.1	本章の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	7.2	DAQ moduleの概要、構成	80
	7.3	DAQ module によるシーケンス制御	82
		7.3.1 normal-mode の動作	82
		7.3.2 test-mode	83
	7.4	読み出し系の性能評価	85
		7.4.1 パルスリニアリティ	85
		7.4.2 チャンネルゲインユニフォーミティ	86
		7.4.3 ノイズレベルの評価	86
		7.4.4 トリガー検出効率	90
		7.4.5 読み出し系のクロストーク	93
		7.4.6 パルスリニアリティについての考察	96
	7.5	結論	101
8	結論		103
-			
Bi	bliog	graphy	103

CONTENTS

谢辞	107
List of Figures	107
List of Tables	111

Chapter 1

ニュートリノとその振動

近年、大気ニュートリノおよび太陽ニュートリノの観測結果からニュートリノ振動を示唆す る強い証拠が示されている。このことはニュートリノが有限の質量を持つこと、すなわち標準 理論を越えたあたらしい素粒子物理学を意味し、現在唯一の実験的手掛かりであるニュートリ ノ振動の研究はそのアプローチと成りうる。また物質と殆ど相互作用しないという特徴が宇宙 の物質進化に本質的な役割を果たし、振動パラメータおよびそのフレーバー混合の物理の研究 は宇宙の形成に関わる問題に対する重要な制限を与え、宇宙論の立場からも非常に興味が持た れるところである。本章ではニュートリノ振動の物理的背景を述べ、これまで行われている実 験的検証の現状を要約する。

1.1 ニュートリノの発見とその歴史

ニュートリノの歴史は 1930 年代見かけ上エネルギーが保存しないようにみえる β 崩壊の現象を説明するために Wollfgang Pauli がその存在を唱え、Enrico Fermi がその理論的体系をつくったことに始まる。現代の理解によるとニュートリノは弱い相互作用しかしないため存在の実証までその後 20 年待たなければならなかったが、現在まで Lerderman,Schwartz,Steinberger による逆 β 過程を用いた実験・LEP 実験における Z ボソンの崩壊幅測定などによりその基本的性質がわかっている。

- 弱い相互作用(および重力相互作用)しかしない中性レプトン

- 種類は各荷電レプトンに結合する ν_e, ν_μ, ν_τ の3種 (~50GeV において)
- 質量がゼロもしくは殆どゼロに近い値である

素粒子の世界の現象を理解するとき、我々は素粒子標準理論を用いる。標準理論ではニュー トリノは質量を持たないものとして扱い、これまで数多く行われてきた素粒子実験の結果を精 度良く記述してきた。しかし質量ゼロとして扱う理論的根拠はなく小さな質量をもつとしても その相互作用の強さはヒッグスを介して質量に比例するため実験結果に矛盾を与えない。また ニュートリノ質量の測定を目的とした実験も行われてきたが、その上限値を与えるにとどまっ ている。

ニュートリノの種類	質量
$m_{ u_e}$	$<\!\!2.5 \text{ eV} [1]$
$m_{ u_{\mu}}$	$<\!\!170 \text{ keV} [2]$
$m_{ u_{ au}}$	< 18.2 MeV [3]

Table 1.1: ニュートリノ質量

1.2 ニュートリノ振動とその物理的背景

ニュートリノには3つのフレーバー固有状態 $|\nu_{\alpha}\rangle(l = e, \mu, \tau)$ がある。ニュートリノが質量を 持つ場合、質量固有状態 $|\nu_{i}\rangle(i = 1, 2, 3)$ とこのフレーバー固有状態は一致せず、その重ね合わ せで表される。

$$|\nu_l\rangle = \sum_i U_{li} |\nu_i\rangle \tag{1.1}$$

ここで*U*は、クォークセクターにおける CKM(Cabibbo-Kobayashi-Maskawa)行列に対応するユニタリー混合行列で MNS(Maki-Nakagawa-Sakata)行列と呼ばれている。この*U*は $c_{ij} = \cos \theta i j$, $s_{ij} = \sin \theta i j$, また CP 非保存の位相 δ を用いて以下のように表される。

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(1.2)
$$= \begin{bmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{bmatrix}$$
(1.3)

我々の観測できるフレーバー固有状態のニュートリノが質量固有状態の重ね合わせであり、 また質量の違いが異なる時間発展を起こさせるという量子力学的見解から、真空中をニュート リノが飛行するときにあるフレーバーから異なるフレーバーへ変化するという事実が導かれる。 この、ニュートリノが質量を持つときに起こるフレーバー間の混合現象を"ニュートリノ振動" と呼ぶ。以下にこの振動確率の算出を行う。

あるフレーバー固有状態 *l* にあるニュートリノが距離 *L* の飛行のあとに *l'* に変化するとき、 その確率振幅 $A(\nu_l \rightarrow \nu_{l'})$ は各質量固有状態 *m* について (始状態 ν_m の振幅) × (ν_m の時間発 展) × (終状態が $\nu_{l'}$ になる振幅) を足しあわせたものであるので、

$$\mathcal{A}(\nu_l \to \nu_{l'}) = \sum_i \mathcal{A}(\nu_l = \nu_i) \mathcal{A}(\nu_i(0) \to \nu_i(t)) \mathcal{A}(\nu_i = \nu_{l'})$$
(1.4)

$$\mathcal{A}(\nu_l = \nu_m) = U_{lm} \tag{1.5}$$

$$\mathcal{A}(\nu_i(0)) \to \nu_i(t)) = \exp(-iE_i t) \tag{1.6}$$

$$\mathcal{A}(\nu_{i} = \nu_{l'}) = U_{l'i}^{*} \tag{1.7}$$

と書ける。これによりその振動確率は

$$P(\nu_l \to \nu_{l'}) = |\mathcal{A}(\nu_l \to \nu_{l'})|^2$$
(1.8)

$$= \left| \sum_{i} \mathcal{A}(\nu_{l} = \nu_{i}) \mathcal{A}(\nu_{i}(0) \to \nu_{i}(t)) \mathcal{A}(\nu_{i} = \nu_{l'}) \right|^{2}$$
(1.9)

$$= Re \sum_{jk} U_{lj} U_{l'j}^* U_{lk}^* U_{l'k} \exp\left(-i(E_j - E_k)t\right)$$
(1.10)

となる。ここに $E_i = \sqrt{p^2 + m_i^2} \simeq p + m_i/2p$, ユニタリー条件より $\sum_i U_{lm}U_{l'm}^* = \delta_{ll'}$ であることを用い、また $\Delta m_{ij}^2 \equiv m_i^2 - m_j^2$ と定義する。

$$P(\nu_{l} \to \nu_{l'}) = Re \sum_{jk} U_{lj} U_{l'j}^{*} U_{lk}^{*} U_{l'k} \exp\left(\frac{-i\Delta m_{jk}^{2}L}{2p}\right)$$
(1.11)

$$= \delta_{ll'} - Re \sum_{jk} U_{lj} U_{l'j}^* U_{lk}^* U_{l'k} \left(1 - \exp\left(\frac{-i\Delta m_{jk}^2 L}{2p}\right) \right)$$
(1.12)

$$= \delta_{ll'} - 4 \sum_{j < k} U_{lj} U_{l'j}^* U_{lk}^* U_{l'k} \sin^2 \left(\frac{\Delta m_{jk}^2 L}{4p} \right)$$
(1.13)

 $|p| \simeq E, c = \hbar = 1$ とした自然単位系での計算を行ったことを考慮すると、最終的に以下の振動確率の式を得る。

$$P(\nu_l \to \nu_{l'}) = \delta_{ll'} - 4 \sum_{j < k} U_{lj} U_{l'j}^* U_{lk}^* U_{l'k} \sin^2 \left(1.27 \Delta m_{jk}^2 [eV^2] \frac{E[GeV]}{L[km]} \right)$$
(1.14)

このようにニュートリノ振動の確率は質量2乗差および混合角をパラメータとしてニュートリノの飛行距離LとエネルギーEによって振動する。

ここで2フレーバー間の振動を考える。このとき混合行列は

$$U = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$
(1.15)

となり、式 (1.14) からニュートリノのフレーバーが保存する、またはしない確率は、

$$P(\nu_l \to \nu_l) = 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \left(1.27\Delta m^2 [\text{eV}^2] \frac{L[\text{km}]}{E[\text{GeV}]} \right)$$
(1.16)

$$P(\nu_l \to \nu_{l \neq l'}) = \sin^2 2\theta \sin^2 \left(1.27 \Delta m^2 [\text{eV}^2] \frac{L[\text{km}]}{E[\text{GeV}]} \right)$$
(1.17)

となる。なお式 (1.17) から

$$\Delta m^2 [\text{eV}^2] \frac{L[\text{km}]}{E[\text{GeV}]} \ge 1 \tag{1.18}$$

でないとニュートリノ振動に対して感度がないことが分かる。これより

$$\Delta m^2 [\text{eV}^2] \ge \frac{E[\text{GeV}]}{L[\text{km}]} \tag{1.19}$$

という関係が得られるが、これが実験において振動パラメータの探索領域の目安となる。

1.3 ニュートリノ振動の実験的検証

1.3.1 Super-Kamiokande における大気ニュートリノ観測

ニュートリノ振動の存在を示唆するものに大気ニュートリノ^{*1}異常の観測事実がある。そも そもこの大気ニュートリノ異常は1980年代に世界各地でおこなわれた核子崩壊の探索を目的 とした地下実験でのバックグラウンドの研究として大気ニュートリノを観測したことに源を発 する。大気ニュートリノの生成過程を示すと、

π^{\pm} μ^{\pm}	\rightarrow \rightarrow	$\mu^{\pm} + \nu_{\mu}\bar{\nu}_{\mu}$ $e^{\pm} + \nu_{e}(\bar{\nu}_{e}) + \nu_{mu}(\bar{\nu}_{\mu})$	(99.98770%) $(\simeq 100\%)$
K^{\pm}	\rightarrow	$\mu^{\pm} + \nu_{\mu}(\bar{\nu}_{\mu})$	(63.43%)
K_S^0	\rightarrow \rightarrow \rightarrow	$ \begin{aligned} \pi^{\pm} &+ \pi^{0} \\ \pi^{\pm} &+ \pi^{+} + \pi^{-} \\ \pi^{+} &+ \pi^{-} \end{aligned} $	(21.13%) (5.576%) (68.60%)
K_L^0	\rightarrow	$\pi^+ + \pi^- + \pi^0$	(12.58%)
	\rightarrow \rightarrow	$\pi^{\pm} + \mu^{\mp} + \nu_{mu}(\bar{\nu}_{\mu})$ $\pi^{\pm} + e^{\mp} + \nu_e(\bar{\nu}_e)$	(27.18%) (38.79%))

となる。大気ニュートリノ問題を論ずるとき、一般にミューオンニュートリノと電子ニュートリ ノのフラックス比 $(\nu_{\mu} + \bar{\nu_{\mu}})/(\nu_{e} + \bar{\nu_{e}})$ が用いられる。これはニュートリノフラックスの絶対量 の予測にはおよそ 20%の不定性があるのに対し、ミューオンタイプと電子タイプの比はずっと 小さな 5%という理論不定性に抑えられるためである。またこの比は上記の生成過程に示したよ うにほぼ 2:1 となる。Kamiokande, IMB-3, Soudan 2, Fréjus, NUSEX の観測結果を Table1.2 にまとめる。表中の R はニュートリノフラックス比の観測値と期待値との比であり

$$R = \frac{(\mu/e)_{measured}}{(\mu/e)_{expected}} = \frac{\left(\frac{\nu_{\mu} + \bar{\nu}_{\mu}}{\nu_e + \bar{\nu}_e}\right)_{measured}}{\left(\frac{\nu_{\mu} + \bar{\nu}_{\mu}}{\nu_e + \bar{\nu}_e}\right)_{expected}}$$

で表される。多くの実験結果は理論値の6割前後のフラックス比 ν_{μ}/ν_{e} を示す。これは観測された ν_{μ} フラックスが理論値よりも小さい、もしくは ν_{e} フラックスが理論値よりも大きいことを表す。この事実が大気ニュートリノ異常と呼ばれている。

現在この大気ニュートリノ異常は $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$ のニュートリノ振動に起因するものと理解されている。以下に Super-Kamiokande における大気ニュートリノ観測の結果の詳細を記す。

Figure 1.1 は sub-Gev および multi-GeV 領域での ν_e , ν_μ の zenith angle distribution である。 検出器上空 $(\cos \theta = 1)$ で生成されたニュートリノの飛行距離は 20km であるのに対し、地球の 反対側 $(\cos \theta = -1)$ から来るニュートリノは 13,000km である。ニュートリノ振動がないとき の分布は上下対称であることが期待されるが、oscillation baseline が zenith angle によって変 化するために振動が存在するときのニュートリノフラックスには上下非対称性が現れる。また

^{*1}地球上空において陽子や核子等の一次宇宙線と大気中の原子核の相互作用によって π 中間子や K 中間子が生成される。この中間子は空中で崩壊し、その過程でミューオンニュートリノや電子ニュートリノを放出する。このように生じたニュートリノを大気ニュートリノと呼ぶ。

	7
Experiment	R
Kamiokande[4]	$0.60^{+0.06}_{-0.05}(stat.) \pm 0.05(sys.)$
IMB-3[5]	$0.54 \pm 0.05(stat.) \pm 0.12(sys.)$
Soudan $2[6]$	$0.68 \pm 0.11(stat.) \pm 0.06(sys.)$
Fréjus[7]	$1.00 \pm 0.15(stat.) \pm 0.08(sys.)$
NUSEX[8]	$0.96^{+0.32}_{-0.28}(stat.)$

Table 1.2: 大気ニュートリノの観測結果

Figure 1.2 には上向き突き抜けミューオンおよび上向きストップミューオンの分布を示した。 地球内部を伝搬して上向き入射する宇宙線ミューオンはほぼ存在しないのでこれらの μ の起源 は地球裏側からやってくる大気ニュートリノが検出器外部の岩盤との反応して生じたものであ り、この突き抜け μ 、ストップ μ の親ニュートリノはそれぞれ ~10GeV,~100GeV の高エネル ギーであるためミューオン入射方向がニュートリノの方向を表す。

分布は μ 事象に対しては非対称性があらわれており、一方 e 事象についてはモンテカルロシ ミュレーションとほぼ一致している。これより大気ニュートリノ異常の原因は $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$ 振動で あると考えられ、この 2 フレーバー間の振動を仮定したときの解析結果は 90% confidence level において

$$\Delta m^2 = 1.6 \sim 3.9 \times 10^{-3} [eV], \qquad \sin^2 2\theta > 0.92$$

という結果が得られている (Figure 1.3)。さらに 3 フレーバー振動解析においては $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$ 振動がないことを示唆し、 θ_{13} への制限は CHOOZ 実験 [9] と一致することが示されている。

またその他の大気ニュートリノ異常の原因の候補としてあげられる $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{s}$ (sterile neutrino) 振動、neutrino decay シナリオに対しては否定的な結果が出ている。



Figure 1.1: sub-GeV, multi-GeV 領域における *e* および μ -like の 1-ring 事象サンプルの zenith angle distribution。データは 1489 日分の fully contained(FC) イベント、multi-GeV μ -like 事象には partially contained(PC) も含まれる。緑のヒストグラムはベストフィットパラメータの時の分布で値は $\Delta m^2 = 2.5 \times 10^{-3}$, sin² 2 $\theta = 1.0$ である。



Figure 1.2: 上向き μ 事象の zenith angle distribution。実データとベストフィット値 $\Delta m^2 = 2.5 \times 10^{-3}$, sin² 2 $\theta = 1.0$ の時の分布。



Figure 1.3: 90%C.L. における振動パラメータの許容領域

1.3.2 その他の振動検証実験

ニュートリノ振動検証を目的とした実験は、

- 原子炉ニュートリノを用いた実験
- 加速器を用いた短基線実験
- 加速器を用いた長基線実験

に分類される。

原子炉ニュートリノを用いた実験は、原子炉で生成される数 MeV の反電子ニュートリノ $\overline{\nu}_e$ を観測するため、式 (1.19) より短い距離でも小さい Δm^2 に感度をもつ。これまで行われた CHOOZ, Palo Verde, Bugey, Krasnoyarsk などの実験からは振動を示すような観測結果を得られてなかったが、昨年に KamLAND 実験 [10] がニュートリノ振動を示す観測結果を示した。 KamLAND 実験は検出器と原子炉の距離が平均 180km という利点を生かし、 $\Delta m^2 \sim 10^{-5}$ [eV²] という領域まで探索できる。

短基線振動実験はニュートリノ飛行距離が $\sim 1 \text{km}$ までの実験で、L/E が小さいため大きな Δm^2 の領域しか探索できない。主な実験に CHORUS, NOMAD, LSND, KARMEN 等がある。

一方長基線実験はニュートリノ飛行距離が数 100km にもなる実験で、準備中のものに MINOS, OPERA, JHF- ν 実験等がある。

次章ではわれわれが行っている、長基線振動実験の一つである K2K 実験について詳しく述べる。

Chapter 2

K2K長基線ニュートリノ振動実験

K2K 実験は 1999 年 6 月に開始された世界初の長基線ニュートリノ振動実験である。茨城県 つくば市高エネルギー加速器研究機構にて生成されたニュートリノを 250km 離れた岐阜県神岡 町の Super-Kamiokande で観測することによりニュートリノ振動現象の確立を目指している。 以下に K2K 実験の測定原理、検出器および 2003 年 1 月現在における最新結果についてまと める。

2.1 実験概要および測定原理

K2K 実験は地球規模の基線、加速器から生成されるニュートリノビームを用いた世界初の 長基線ニュートリノ振動実験であり、Super-Kamiokandeの大気ニュートリノ観測結果により 示唆された $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$ 振動の検証をおこなう (Figure 2.1)。



Figure 2.1: K2K 実験

ニュートリノビームは高エネルギー加速器研究機構 (KEK) の 12GeV 陽子シンクロトロンか ら取り出される陽子ビームを Al 標的に当て、生成される π 中間子の崩壊 $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$ によって得 られる。なおこのビームはほぼ純粋なミューオンニュートリノであり、平均エネルギー 1.3GeV の広がった分布をもつ。KEK 所内にはビームモニターおよび前置検出器が設置されており生成 直後のニュートリノエネルギースペクトル・フラックス・角度分布を測定し、その測定結果から 250km 離れた Super-Kamiokande でのスペクトルを予測する。この予測と Super-Kamiokande での観測結果の比較からニュートリノ振動の検証、また振動パラメータ $\Delta m^2, sin^2 2\theta$ の測定を 行う。K2K 実験において探索可能なニュートリノ振動パラメータ領域を Figure 2.2 に示す。

2.1.1 ニュートリノ反応カテゴリ



Figure 2.2: K2K 実験の $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_X$ 振動に対する感度。90%C.L. で探索可能な領域を示した。

 ν_{μ} のエネルギースペクトル測定には荷電カレント準弾性散 乱 (Charged Current Quasi-elastic Scattering, 以後 CCQE と略す) イベント $\nu_{\mu} + n \rightarrow \mu^{-} + p$ を選び出す必要がある。 この CCQE 反応は運動学的に 2 体散乱にとして扱えるので ニュートリノエネルギー E_{ν} はミューオンのエネルギー p_{μ} および散乱角 θ_{μ} から (Figure 2.3) 以下の式によって求めら れる。

$$E_{\nu} = \frac{m_N E_{\mu} - m_{\mu}^2/2}{m_N - E_{\mu} + p_{\mu} \cos \theta_{\mu}}$$
(2.1)



Figure 2.3: ニュートリノエネル) ギー再構成

ニュートリノ反応にはこの CCQE の他に非弾性散乱 (non-QE)の荷電カレント反応および中性カレント (Neutral Current,NC)反応でメソンを生成するものがある。また NC の弾性散乱反応は観測にかからない。 K2K 実験における 1GeV あたりのエネルギー領域でのニュートリノ反応の割合を Table2.1 に 記す。

観測において CCQE 反応を同定するには生成されるミューオンおよび陽子を検出する必要 がある。K2K のニュートリノビームで生成される p は多くが 1GeV/c 以下のものである。この ような低エネルギー陽子は dE/dx が大きく、飛程は短い (数 10cm~< 1m)。また non-QE 反応 によって生成される π を p と誤認識する可能性もある。以上のような事象がニュートリノエネ ルギー再構成時のバックグラウンドとなる。

$CCQE(\nu N \to lN')$	$\sim 30\%$
CC 1-meson $(\nu N \rightarrow lN' + m)$	$\sim 29\%$
NC 1-meson $(\nu N \rightarrow \nu N' + m)$	$\sim 10\%$
CC multi-pion $(\nu N \rightarrow lN' + \pi + \pi \cdots)$	$\sim 13\%$
NC elastic scattering $(\nu N \rightarrow \nu N)$	$\sim 13\%$

 Table 2.1:
 Neutrino Interaction



Figure 2.4: CCQE反応

Figure 2.5: non-QE反応

2.1.2 振動パラメータの測定原理

K2K 実験は $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$ 振動の検証を目的としている。しかし先ほども述べたように本実験の ニュートリノビームはおよそ 1.3GeV であり τ 粒子生成のしきい値 3.45GeV を越えないため振 動によって出現する ν_{τ} を検出できない。そのため振動がある場合には Super-Kamiokande での ミューオンニュートリノ観測事象が予測値より減少する disappearance 型の実験となる (対して振 動により変化した先のニュートリノを検出する実験を appearance 実験と呼ぶ)。 disappearance 実験は技術的には難しいが、振動した先のニュートリノのフレーバーに依らずニュートリノの 数の減少を観測することによりニュートリノ振動の有無を一般的に検証できる。

また振動パラメータの導出の流れは以下の通りである。

- 【1】前置検出器における各ニュートリノ反応イベントカテゴリについての p_{μ}, θ_{μ} 分布の測定
- 【2】前置検出器でのニュートリノエネルギースペクトルの導出
- 【3】前置検出器の測定結果の外挿による Super-Kamiokande での振動なしの時のニュートリ ノエネルギースペクトルの分布予想
- 【4】Super-Kamiokande における観測結果
 - ニュートリノ観測数
 - (再構成された) ニュートリノエネルギースペクトル
- 【5】Super-Kamiokande でのニュートリノ観測数、スペクトルを用いた $sin^{2}2\theta$, Δm^{2} をパラ メータとしたフィッティング

以上のような実験、解析を可能にするために K2K 実験ではそれぞれ異なる役割を担った数 多くの装置、検出器構成が存在する。これについて以下に順を追って触れていく。







Figure 2.7: 2つの電磁ホーン。Al 標的でもあ る第1ホーンの直径は30mm、長さは660mm。

Figure 2.8: SK において期待される ニュートリノフラックス (Monte Calro simulation)。網掛ありはホーン電流 0A の場合。

PIMON の役割は生成直後 π^+ の運動量、角度分布を測定することにより、前置検出器と Super-Kamiokande でのニュートリノフラックスの比を求めることである。250km 離れた Super-Kamiokande ではニュートリノ生成地点である Decay Volume を点源として扱えるが、数 100m 下流の前置検出器ではこの有限の大きさを無視できない。

PIMON はリングイメージ型ガスチェレンコフ検出器であり、異なるガス屈折率における π^+ が出すチェレンコフ光の方向、角度の測定から運動量とその分布を求める (Figure 2.9)。なお 12GeV 陽子ビームがチェレンコフしきい値をこえる領域では測定不能なため 1GeV 以下のニュー トリノに関しては感度がない。PIMON での測定結果を Figure 2.10 に載せる [11][12]。

2.2.3 MUMON – ミューオンモニター –

decay pipe の後には 3.5m の鉄、2m のコンクリートから成るビームダンプが設置されてお り、1 次陽子や pipe 内で崩壊しなかった π^+ が吸収される。このビームダンプ直後に MUMON と呼ばれるビームモニターが設置されている。この MUMON はビームダンプを突き抜けてき た π^+ 崩壊による高エネルギーの μ^+ を検出する。 μ^+ のプロファイル、強度をスピルごとにモ ニターすることによりニュートリノビーム方向の安定性を保証する (Figure 2.11)。

MUMON の構成は $2m \times 2m$ の He ガスイオンチェンバーとシリコンパッドアレイであり、チェンバーがビームプロファイル、シリコンパッドがビーム強度測定の役割を担う。この下流 70m に前置検出器が位置し、MUMON から前置検出器までの地中通過時に μ^+ 等も止められてほぼ 純粋なミューオンニュートリノビームが得られる。



Figure 2.9: *π*中間子モニターの概要。チェ レンコフ光は球面鏡によって反射され、focal plane 上の PMT array によって検出される。 ビーム軸方向にでたチェレンコフ光は focal plane 中央に収束させられるのでリングの中 心からのずれで π^+ の角度分布、またリング 径から運動量がわかる。

D

П

Ο

SSD-Array

Ď

beam line

Y-readou Electrod (32ch)

Mu2

 μ –SPIC

 μ –pit floor



3



2.3 前置検出器

K2K 実験における前置検出器は 水チェレンコフ検出器と3つの Fine Grain 検出器から成る。前置検出器 ではニュートリノビーム生成直後の エネルギースペクトル、フラックス、 ν_e 混入率を測定する。またニュート リノ反応を用いたビームプロファイ ルのモニターも行う。Al ターゲット 300m 下流のニュートリノホールに 設置されたこれらの検出器を順に説 明していく。



2.3.1 1kt 水チェレンコフ検出 器

1kt 検出器はその名が示すように 直径 10.8m、高さ 10.8mの円柱型の 水槽に 1000t 超純水が満たされてお

Figure 2.12: K2K前置検出器。上流 (右) から 1kt, SciFi, 、 LG, MRD。

り、荷電粒子が通過することによって生じるチェレンコフ光を検出する。検出器内部は内水槽、 外水槽に分かれており、各々680本、68本の光電子増倍管が備え付けられている。内水槽には Super-Kamiokande と同じ20インチ光電子増倍管が使われており、光電面の面積は内水槽の 40%を覆う。これは Super-Kamiokande と同じ値である。

1kt はこのように SK と同じ検出器構成をしているので、ニュートリノイベント数の振動解 析においてこの検出器をもちいてフラックスの normalization を行うことで多くの系統誤差を キャンセルした Super-Kamiokande での期待されるイベント数を求めることができる。

またニュートリノ反応で生じる反跳陽子はチェレンコフしきい値を越えないため CCQE 反応 をもちいたニュートリノエネルギー再構成時には 1-ring μ -like イベント^{*1}を用いる。このとき non-QE のバックグラウンドが 20 さらにエネルギー再構成のためにはミューオンは検出器内で 止まらなければならないので 1GeV 以上のニュートリノに対しては検出効率が悪くなる。K2K 実験においては低エネルギー領域において感度のよい検出器といえる。

2.3.2 SciFi – シンチレーションファイバー検出器 –

1ktの下流に位置するのがシンチレーションファイバー検出器であり、240cm×240cm×6cmの水標的タンクとXおよびY方向にシンチレーションファイバーを積んだシートを交互に並べたサンドウィッチ構造になっている。水標的で反応した荷電粒子の飛跡をfine grainなファイバーでとらえる。全20層のシンチレーションファイバーシートの読み出しにおいてはファイバーをバンドル状にして Image Intensifier Tubeと CCDを用いる。そのためSciFi自身の時間分解能は非常に悪く(~100µs)、上流および下流にトリガーカウンタとしてプラスチックシンチレータを設置している。上流のカウンタはSciFi外からくる粒子によるイベントにvetoを施し、また下流カウンタのヒットポジション、タイミングとSciFi内事象を選び出す。なおこの

^{*1}後置検出器の説明で述べるが、一つのチェレンコフリングが検出され、かつ µ 粒子の飛行によるリングパターンに近い事象。

トリガーカウンタに関しては 2002 年 12 月にアップグレードがなされ、トップ、サイドにもシ ンチレータが設置されている。

2.3.3 LG – 鉛ガラスカロリメータ –

 $133mm \times 122mm \times 340mm$ の鉛ガラスブロックを 12×5 に積み上げたものを 1 モジュール としてそれを 2×5 に積まれた検出器、 ν_e 事象検出する。計 600の鉛ガラスブロックは各々光電 子増倍管で読まれる。この検出器の ν_e 混入率測定から Super-Kamiokande での ν_e appearance に対する結果は 2 イベントの観測数にたいして振動なしの時の期待値 2.9 ± 0.9 となっている。

2.3.4 MRD – ミューオンレンジ検出器 –

MRD はニュートリノ反応によって生じるミューオンを測定することにより、直接的にニュー トリノビームのプロファイルを測定し、その安定性をモニターする。検出器は鉄板とドリフト チェンバーが交互に並んだ構造をしている。鉄は上流に 10cm 厚のものが 4 層、下流に 20cm のものが 8 層の計 12 層で総重量 864t にもなるのでニュートリノ反応数が多い。反応で生じる ミューオンの飛程からエネルギーを測定する。また SciFi で起こったニュートリノ事象からく るミューオンのエネルギー測定という役割も担う。

2.4 後置検出器 – Super-Kamiokande-

K2K 実験にて後置検出器となる Super-Kamiokande を Figure 2.13 に示す。この検出器は 41.4m、直径 39.3mのタンクに超純水が満たされたリングイメージ型水チェレンコフ検出器で ある。岐阜県神岡町の山頂下 1,000m(2,700m 水相当) に建設されており、宇宙線バックグラウ ンドは地表の 10⁻⁵ まで抑えられる。タンク内部は内水槽と外水槽に光学的に仕切られており、 内水槽には 20 インチ光電子増倍管が 11,146 本^{*2}、外水槽には 8 インチ光電子増倍管が 1,885 本取り付けられている。内水槽においては光電面が 40%の面積を覆い、また外水槽では波長変 換剤入りプラスチックを増倍管に取り付けることによって検出効率を上げている。

ニュートリノ反応から出てくるミューオンおよび電子等の粒子識別には、チェレンコフ光の角 度、リングの形を用いて行う。電子の飛行により観測されるチェレンコフリングは、電子がシャ ワー反応を起こすためそのリングがぼやけたものになり、一方ミューオンによるものはきれい なリングが検出される。なお CCQE 反応事象は陽子がチェレンコフ光を出さないため、ミュー オンによるリングだけが見える 1-ring μ-like 事象となる。

また、K2K 実験におけるニュートリノビームと同じエネルギー領域には大気ニュートリノ があり、K2K ニュートリノ観測の際のバックグラウンドとなりうる。Super-Kamiokande での 大気ニュートリノのイベントレートは ~8 events/day である。しかし GPS(Global Positioning System) システムを用いて (時間精度 100ns) ビームスピルに同期した $1.5\mu s$ のゲートを設ける ことにより大気ニュートリノとの accidental coincidence は ~ $O(10^{-5})$ まで小さくなる。

^{*2}2001 年 11 月に PMT 破損事故があり昨年に再建作業がなされた。現在では建設当初の 47%の光電子増倍管数 にて稼働中である。



Figure 2.13: Super-Kamiokande 概略図

2.5 解析結果

1999 年 6 月から 2001 年 7 月までの 4.8 × 10¹⁹ POT (Protons On Target) 相当のデータに基 づくニュートリノ振動解析結果 [13] を以下にまとめる。

Super-Kamiokande で観測された fiducial volume 内の事象数は 56 イベント、また null oscillation の時に期待される事象数は $80.1^{+5.4}_{-6.2}$ である (Table2.2)。観測された 56 事象のうち 1-ring μ -like イベント 29 サンプルをスペクトル解析にて用いる。

	観測数	期待值 (null oscillation)
Total (FC, 22.5kt fidutial)	56	$80.6^{+7.2}_{-8.0}$
1-ring	32	48.4 ± 6.7
$(\mu$ -like)	30^{*3}	44.0 ± 6.8
(e-like)	2	4.4 ± 1.7
multi-ring	24	32.2 ± 5.3

Table 2.2: Super-Kamiokande におけるニュートリノ事象数と振動がないときの期待 値。イベント選択は大気ニュートリノと同じ手順である。加え、ビームス ピルタイミングと同期した FC(fully contained) イベントの内、ニュート リノ反応点が 22.5kt の基準体積内にあるもの記した [14]。









Figure 2.16: SciFi 検出器で測定された $p_{\mu}, \theta_{\mu}, E_{\nu}^{rec}$ 分布





Figure 2.18: Super-Kamiokande における reconstructed E_{ν} 分布。エラーバー付きポ イントはデータ、ボックスヒストグラムは振動なしの時に期待されるス ペクトル、実線のヒストグラムはベストフィット値の振動パラメータの 時のスペクトル。ヒストグラムは観測されたイベント数で規格化してあ る。なお破線は振動なし、期待される観測数で規格化したもの。

振動パラメータ

2フレーバー間のニュートリノ振動解析はイベント数およびスペクトル形による likelihood を定義して maximum-likelihood 法を用いて行う。

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{norm}(\Delta m^2, \sin^2 2\theta, f) \cdot \mathcal{L}_{shape}(\Delta m^2, \sin^2 2\theta, f)$$
(2.3)

 \mathcal{L}_{norm} は前置検出器からのイベント期待数を用いたときの Super-Kamiokande での 56 の FC イ ベントを観測する Poisson 分布確率である。 \mathcal{L}_{shape} は

$$\mathcal{L}_{shape} = \prod_{i=1}^{N_{1R\mu}=29} P\left(E_i; \Delta m^2, \sin^2 2\theta, f\right)$$
(2.4)

で表される、1-ring μ -like イベント各々に対して $E_{\nu}^{rec} = E_i$ となる確率を 29 イベント掛け合わ せたものであり、なおパラメータ f は系統誤差からくる constraint term である。

この likelihood による振動パラメータのベストフィット値は

 $\Delta m^2 = 2.8 \times 10^{-3} [\text{eV}^2], \qquad \sin^2 2\theta = 1$

であり、99%の確率でニュートリノ振動を示唆する。また Figure 2.19 に振動パラメータの許容 領域を示した。そのパラメータ値は 90% C.L. にて

$$\Delta m^2 = 1.5 \sim 3.9 \times 10^{-3} [\text{eV}], \qquad \sin^2 2\theta = 1.0$$

となっている。図中には Super-Kamiokande の大気ニュートリノ観測結果も示されているが、 K2K 実験の結果はこれと非常に良い一致を見せている。



Figure 2.19: K2K 実験による振動パラメータ許容領域。68%,90% 99% C.L の領域を 示した。なお破線は Super-Kamiokande による大気ニュートリノ観測に よる結果。

Chapter 3

全感知型シンチレータ飛跡検出器の導入

われわれは K2K 実験の前置検出器のアップグレード計画として鉛ガラス検出器と入れ替えて 導入するシンチレータトラッカーを現在開発中であり、2003 年度夏に実機をニュートリノホー ルに導入してニュートリノデータ取得を開始する。この章ではシンチレータトラッカー開発の 動機、検出器詳細とその基本性能を述べる。

3.1 動機

前章でまとめたように K2K のニュートリノ振動解析結果は 99% でニュートリノ振動の示唆を 与え、振動パラメータの許容領域は Super-Kamiokande の大気ニュートリノの観測結果と非常 によい一致を見せる。K2K 実験の最終目的はニュートリノ振動の確立すなわち null oscillation の 99.9%レベルの棄却、またニュートリノ振動パラメータの精密測定であり、このためには実 験誤差 (統計誤差、系統誤差)を抑えることが重要である。

- 統計誤差: Super-Kamiokande でのニュートリノフラックスは前置検出器の~10⁻³ 倍で、実際 に観測されたニュートリノビームイベントは56 イベントと少ない。特にエネルギースペ クトルの歪みの解析においてはそのうちの 1-ring μ-like の 29 イベントしか用いてない。 これは1-rign μ-like 事象のおよそ 50%が CCQE 反応事象であり、Super-Kamiokande に おけるイベント分類でイベント再構成時のニュートリノエネルギースペクトルに混入す る non-QE バックグラウンドが最も少ないためである。しかし統計面での改善のためには 1-ring μ-like 以外の multi-ring を生成する事象を用いることが必要である。この multi-ring イベントは主に π 中間子生成反応などの non-QE イベントであり、上記のような解析に はこの π 中間子生成反応などのニュートリノ反応の詳細な研究を行わなくてはならない。
- 系統誤差:式 1.16 および 2.5 節で示した結果から K2K 実験においては 1GeV 以下の低エネル ギー領域で oscillation maximum になることが示唆される (Figure 2.18, 3.1)。そのため 振動パラメータの精密測定のためには低エネルギー領域のニュートリノ反応事象にたい する高い検出効率およびこの領域での精密なフラックス測定が必要とされる。現在の前 置検出器 1kt、SciFi について述べておくと、1kt は低エネルギー領域においては非常に 感度が良いが、CCQE 反応の陽子を検出できないためバックグラウンドとなる non-QE イベントとの区別ができない。SciFi においてはニュートリノ反応ターゲットである 6cm の水タンクという不感領域、またこのタンクを 2 層以上突き抜けないとトラックとして 認識されないため、そもそも低エネルギー領域での検出効率は低い。



Figure 3.1: 振動なしのときに対する振動 ありのときのニュートリノ観測数の比 (モ ンテカルロシミュレーション)。 $\Delta m^2 = 3 \times 10^{-3}$ あたりの振動パラメータでは1GeV以 下に大きな歪みができる。

以上現存する問題の解決を目的とし、K2K 実験におけるニュートリノ振動探索感度の向上を 目的として我々は前置検出器の弱点を補うあらたな検出器を導入する。またその際、検出器に 要求する性能は以下のようになる。

- 低エネルギーニュートリノ事象の観測:
 ファインセグメント化されていることが必要。かつ不感領域を無くすために検出器自体がニュートリノビームのターゲットでなくてはならない。
- ニュートリノフラックスの精密測定:
 CCQE反応イベントに対する高い検出能力が求められる。このためS/N比 (QE/non-QE)
 の良いシグナル検出、すなわち p/π に対する高い粒子識別能力が必要となる。

このような要請に対してわれわれが開発したのは全感知型シンチレータ飛跡検出器 (シンチ レータトラッカー) である。このシンチレータトラッカーの概要を次節で説明する。

3.2 検出器の概要

われわれの導入するシンチレータトラッカーの概要を Figure 3.2 に示す。検出器は短冊状の プラスチックシンチレータ、波長変換ファイバー、マルチアノード光電子増倍管から構成され る。検出器は 64 層のレイヤー構造をしており、各レイヤーは X 方向 (縦) に 116 本、Y(横) に 118 本シンチレータを重ね並べたものからなる (信号が読み出されるのは X,Y それぞれ 112 本 である)。シンチレータ1 本当たりサイズは $13 \times 25 \times 3000 mm^3$ 、またこのシンチレータは押 し出し型シンチレータと呼ばれ、製造時にファイバーを通すための ϕ 1.8mm の穴、またその周 りには反射材がコーティングされて製作される。シンチレータおよび各レイヤーは隙間なく並 べ、また各シンチレータは反射材によって光学的に分割されるので全感知型かつファインセグ メント化された検出器を実現する。

この検出器を通過する粒子によるシンチレーション光は各シンチレータに挿入された波長変 換ファイバーの光の吸収・再発光の過程 [15] を通じて読み出される。このファイバー読み出し のための光検出器にはマルチアノード光電子増倍管を用いる。またこの検出器の読み出しの ために新たなエレクトロニクスも開発した。この読み出しエレクトロニクスについては次章の Chapter 4 にて説明する。



3.3 本検出器での研究

新検出器であるシンチレータトラッカーはセグメント化され、25×25×13mm³単位からの 位置検出が可能であるとともに不感領域がない。そのためエネルギー損失の高精度測定・粒子 の飛程の測定による高い粒子識別能力、またその飛跡から求められるニュートリノ反応点の位 置分解能は~4mm 程度と期待され、これまで不定性の多かったニュートリノ反応の素性に迫 る。我々はニュートリノフラックス、またバックグラウンドの研究として以下のようなニュー トリノ相互作用の解析を行う。

- $\nu_{\mu} + n \rightarrow p + \mu$ (CCQE 反応)
- $\nu_{\mu} + n \rightarrow p + \mu + \pi$ (CC-1 π 生成反応)
- $\nu_{\mu} + n \rightarrow p + \mu + m\pi \ [m \ge 2]$ (CC-multi π 生成反応)
- $\nu_{\mu} + p \rightarrow \nu_{\mu} + p$ (NC 反応)
- $\nu_{\mu} + p \rightarrow \nu_{\mu} + n + \pi^0$ (NC 反応)
- $\underline{\nu_e + n \rightarrow p + e}$ (ν_e の混入率)

なお ν_e の検出能力を上げるために我々は γ コンバータとして Pb 層を混ぜたレイヤーを検出 器最下流に設置する。

3.4 実験スケジュール

2003年夏に検出器のフルインストールを行う予定であり、その秋からニュートリノデータ取 得を開始する。1~2年のニュートリノビームランで統計を貯め、順次解析を行っていく予定で ある。また先立って2002年冬に4レイヤーの部分的インストールを行い、ニュートリノビーム を用いて検出器のテストを行う。なおシンチレータ、波長変換ファイバー、マルチアノード光 電子増倍管、読み出し用エレクトロニクス等の各コンポーネントの準備も逐次進行中である。

Chapter 4

シンチレータトラッカーの読み出し系

本論文で行った研究はシンチレータトラッカーの読み出し系の開発である。シンチレータト ラッカーの読み出し系を構成する3つの要素、「8×8マルチアノード光電子増倍管」、「VA/TA フロントエンドエレクトロニクス」、「VA/TA 読み出し用 DAQ module」についてそれぞれ性 能評価、また開発を行った。本章では検出器の読み出し系全体を説明し、次章から述べるこれ ら3つの読み出し系の構成要素についての導入を行う。

4.1 シンチレータトラッカーにおけるシグナルの読み出し

われわれはこれまで、セグメント化されたシンチレータと波長変換ファイバーを用いた検出 器の基本性能および実機導入箇所でのバックグラウンド測定等を行い[15][16]、このような読み 出し手法でわれわれの目的とするニュートリノフラックスの精密測定、ニュートリノ相互作用 の研究が行えるだけの検出器性能が得られることがわかった。しかしこの検出器を実機として 導入するためには次のような課題が残る。

- 検出器導入場所に空間的制限がある一方で、多くのニュートリノ反応事象を検出し、また飛跡検出能力を上げるためにシンチレータトラッカーのサイズ自体は極力大きくしなくてはならない。そのためにはファイバーからのシグナルを読み出す光検出器はコンパクトなものである必要がある。
- 検出器チャンネル数が14,336にもなり、フロントエンド部での読み出しチャンネルのシリアル化が必須。またそのシリアル化を行うエレクトロニクス自体もコンパクトでなくてはならない。

そこでわれわれは、波長変換ファイバーの光検出には"64ch マルチアノード光電子増倍管"、 そのマルチアノード信号のフロントエンド部でのシリアル化には "VA/TA" と呼ばれる専用 IC チップを用い、また、VA/TA フロントエンドの読み出しのために"DAQ module" と呼ぶ読み 出し回路を開発した。これらでシンチレータトラッカーのコンパクトかつシリアル化した読み 出しをおこなう。

なお、その読み出し系の構成要素を以下に説明する。

64ch マルチアノード光電子増倍管

64ch マルチアノード光電子増倍管とは 64 チャンネルのアノードを持った光電子増倍管であり、 2×2mm² のピクセルが 8×8 に並んだ非常にコンパクトな光検出器である。1 ピクセルに一本 のファイバーがコンタクトし、この光検出器一つで波長変換ファイバー 64本の信号検出が行 える。

VA/TA フロントエンドボード

マルチアノードの 64の出力をシリアル化して1チャンネルにするためのフロントエンド回路 である。VAとはアナログマルチプレクスの機能を持ったICで、これを用いてマルチアノード の出力をシリアル化する。なお、TAとはトリガー出力を作り出すICである。

VA/TA フロントエンド読み出し用 DAQ module

シリアル化したマルチアノードの出力を読み出す VME モジュールである。また、VA および TA の動作の制御もおこなう。

なお、シンチレータトラッカーのシグナル読み出しの構成図を Figure 4.1 に載せる。



Figure 4.1: シンチレータトラッカーにおけるシグナル読み出し部の構成

4.2 本論文での研究

本論文にてシンチレータトラッカーの読み出しに関して行った研究は以下の通りである。

- 64 チャンネルマルチアノードの性能評価 (Chapter 5)
- VA/TA フロントエンドエレクトロニクスの開発 (Chapter 6)
- VA/TA フロントエンド読み出し用 DAQ module の開発 (Chapter 7)

マルチアノードに関してはその性能評価とともにわれわれの検出器性能を最大限に引き出す ための考察を行った。マルチアノード読み出しのためのフロントエンドボード、DAQ module に関しては、開発時に行った研究をまとめるとともに読み出し系エレクトロニクスの性能評価 もおこなっている。

これらの報告を以降3章にて行う。
Chapter 5

8×8マルチアノード光電子増倍管

われわれの導入するトラッカーはおよそ 15,000 という膨大な読み出しチャンネルを有し、ま たアップグレード計画として鉛ガラス検出器の設置されていた箇所にインストールされる検出 器であるため空間的制限も厳しい。われわれの検出器にとっては、マルチアノード光電子増倍 管のようなコンパクトな光検出器を用いることで検出器の有効体積を最大限まで大きくする事 が可能であり、またチャンネルあたりのコストパフォーマンスが良いため非常に魅力的である。 浜松ホトニクス製マルチアノード光電子増倍管 H7546 は8×8 に並んだ 64 チャンネルのアノー ド出力をもつ。本章では本検出器での使用に際してこの H7546 の基礎研究を行い、我々の光検 出に課せられる要求を満たすことを研究結果とともに示す。

5.1 H7546

議論に入る前に浜松ホトニクス製マルチアノード光電子増倍管 H7546 についてまとめる。 H7546 は 1 辺 2mm のピクセルが 0.3mm 間隔で 8 × 8 に並んだ構造をしている。ピクセルサ イズが非常に小さいため光電陰極、第 1 ダイノード間で起こるチャンネル間クロストークの大 きさが使用に際しては問題となってくる。ダイノード構成は 12 段、High Voltage の分割パラ メータは初段側に重みをかけるようになっており、光電面から放出される光電子の収束能力を高 めている。また光電面の材質はバイアルカリ、300 ~ 650nm の波長帯域に感度を持つ。(Table 5.1, Figure 5.1)。

Parameter	Description/Value
光電面の材質	Bialkali
感度をもつ波長帯域	300-650nm
量子効率	$20~\%~(390 {\rm nm})$
ダイノード構造	Metal Channel Dynode
ダイノードステージ数	12
アノードサイズ (1 チャンネル当たり)	$2 \times 2mm^2$
チャンネル当たりのパルスリニアリティ	$0.6 \text{mA} \ (\pm 5\% \text{ deviation})$

Table 5.1: H7546 の特性リスト



Figure 5.1: H7546の特性。ブリーダ抵抗等のダイノード構成、アノードパターン、入 射光波長に対する量子効率を示した。

5.2 光検出器に課せられる要求

押し出し型シンチレータ+波長変換ファイバーの読み出しにはマルチアノード光電子増倍管 は非常に魅力的であるが、われわれの検出器での使用には以下のような性能が必要である。

光電子数 ~ $\mathcal{O}(100)$ までのリニアリティ 2.1.2節でも述べたようにニュートリノエネル ギー再構成は CCQE 反応のイベントサンプルから行う。CCQE 反応を選び出すには陽子 の出現を識別することが必要であり、このためには陽子/ π 中間子の識別能力が問われる。 この p/π 識別方法として dE/dx の違いを用いる。低エネルギー陽子による1セル当たり のシンチレータの発光量は $\mathcal{O}(100)$ photoelectrons(p.e.) になるので、この低エネルギー陽 子の検出時にもサチュレーションがないことが要求される。サチュレーションの定義を ノンリニアリティ(線形性からの出力のずれ)対して 10%と定める。

低レベルシグナルに対する検出能力 われわれの用いるシンチレータおよび波長変換フ ァイバーにおいて、荷電粒子がビーム軸方向13mm厚のシンチレータを通過した際の Minimum Ionizing Particle(MIP)シグナルはファイバーでの減衰によりマルチアノード に一番近い箇所で20p.e.相当、最も離れた3.5mの検出地点での光量は7p.e.程度になる。 またセルをかすめて1シンチレータ内での粒子の飛行距離が短いときのシグナルも数p.e. まで小さくなることが予想される。読み出し系においてはこれらの低レベルシグナルを 判別できるだけ良いS/N比(MIPシグナル/ノイズ比)、またセルフトリガーでの動作が 必要であるのでその検出能力をあげるためにもゲインは出来得る限り高い方が望ましい。 低いチャンネル間クロストーク率 マルチアノードは集積化した構造上クロストークという問題が存在する。マルチアノードのクロストークとはあるピクセルに入射光があったときに隣接する光の入射のないピクセルにも信号出力が現れる現象である。この原因は光電子の収集効率に起因するもの、すなわちあるピクセルに光が入射して生成された光電子が隣接するチャンネルの第1ダイノードを叩いてしまうことによるもの、さらにはダイノードでの増幅時における隣接するダイノードへのleak charge などが考えられる。クロストークの存在は荷電粒子の飛跡を検出する際に MIP シグナルと誤認してしまうとともに、そのエネルギー情報の損失を意味する。検出器の性能を落とさないためにも十分低いクロストーク率を要求する必要があり、我々は3%を要求した。

高い時間分解能 シンチレータトラッカーでは、TMC にてそのヒットタイミング情報を 記録する。その目的はニュートリノ反応事象と宇宙線等によるバックグラウンドとのイ ベントの分離であり、ニュートリノビームの1バンチ幅50nsを識別できるための時間分 解能 (~10ns) が必要である。シンチレータおよび波長変換ファイバーの decay constant はそれぞれ2ns, 10ns 程度であり、このシンチレータ+波長変換ファイバー読み出しの時 間分解能も同程度になる。マルチアノードの時間分解能は少なくとも10ns 以下でなくて はならない。

われわれの検出器における要求に応える以上の基本特性を満たすものかどうか、またどのような使用条件で満たされるかを追って評価していく。

なおマルチアノードに対して行った評価項目は以下の通りである。

- ゲイン曲線
- ダークカレント
- パルスリニアリティ
- チャンネル間クロストーク率
- チャンネルユニフォーミティ
- 時間分解能

5.3 テストセットアップの構成

まず、本測定における基本的なテストセットアップを以下に示した (Figure 5.2)。その構成 を順に説明していく。

- Blue LED & 波長変換ファイバー Y-11 200MS: 光源には blue LED を用い、入射パルス はシンチレーション光と同程度の発光時間にするために 20ns 幅とした。PMT の量子効 率は波長に依存するため LED 光を波長変換ファイバーに照射し、ファイバーの emission 光を用いることで実機での読み出しと同じ条件を課す。波長変換ファイバーには Kuraray 製 Y11-200MS (マルチラッドタイプ [15]、 *φ*0.7)を用いた。これは実機で用いるものと同 タイプのものである。またファイバー長は 2m、照射位置は端から 1m の中央のポイント である。
- 光量モニター (1) Photo Diode S1227-1010BQ, HAMAMATSU: LED の発する光を 直接検出して長期測定時の発光量の安定性を保証する。LED の発光量は 1%以内で安定 である (Figure 5.3)。



Figure 5.2: テストセットアップの構成。波長変換ファイバーは LED 光入射位置の 5mm 以外は遮光用のチューブの中を通してある。

- 光量モニター (2) 2-inch PMT R2256-02, HAMAMATSU: photo diodeはそれほどゲ インが高くないため低光量のテスト時にはモニターとして不向きである。そのためマルチ アノードと反対側のファイバー端に 2-inch PMT を設置した。パルスごとに 2-inch PMT に対するマルチアノードの信号出力の比を求めることにより LED 光のばらつきがキャン セルする。またこの 2-inch PMT は事前にキャリブレーションを行っており、1p.e. 検出に 十分なゲイン、今回のテストでの測定領域においてのリニアリティを保証する。H7546 と 同じバイアルカリ製、また LED の照射位置は cm のオーダーで制御したのでファイバー 内 1m 減衰後の両端での光量は < 1% で同じである。この PMT 出力を reference として 用いて H7546 への入射光量が得られる。
- ND filter: リニアリティ等の評価を行う際、光源である LED の発光量を変化させることは 望ましくない。LED への入射パルス高を小さくさせていったときに LED 自体の発光効 率が変化する可能性がある。そのために減光には ND フィルターを用いた。この ND フィ ルターはステッピングモータを内蔵しており、ステージコントローラでそのフィルター の回転角を自動制御してファイバーへの入射光量を調節する。
- Moving stage: マルチアノードへの入射位置の設定においては、波長変換ファイバーを挿入・接着した黒アクリル製クッキーをの自動ステージ上に固定し、ステージコントローラを用いてファイバー位置を変化させた。
- **CAMAC 16ch charge sensitive ADC**: マルチアノードおよび各光量モニターの信号の読 み出しには CAMAC charge sensitive ADC を用いた。conversion factor は 0.25pC/count である。
- **CAMAC 12bit High Resolution TDC**: High Resolution TDC(HR-TDC) は時間分解 能測定時のシグナルタイミングの記録に用いた。100ns フルレンジ、25ps/count の conversion factor である。



Figure 5.3: LED 発光の安定性。測定中において photo diode でモニターしたが±1%で 安定していた。photo diode の ADC 値の平均に対する 100 イベントごと の分布の平均の割合を、時間変化 (イベント番号) に沿って表した。

5.4 ゲイン曲線およびダークカレント

まず H7546 のゲイン曲線を求めた (Figure 5.4)。高い印加電圧においては gaussian fitting を行った 1p.e. ピークよりゲインを算出し、低ゲインの領域においては浜松ホトニクス製 high speed amplifier C5594 (増幅率 63dB) をもちいてシグナルを増幅して 1p.e. ピークを求めた。

なお、低い電圧設定値では 1p.e. の波高分解能が悪いので精度のよいゲイン値が得られない。 そこでマルチアノードのゲインの導出方法として photon 統計による算出も行っている。入射光 量を photoelectron 数 $N(\lambda$ 射光子数 × 量子効率)、ゲインを G、出力信号の分布の mean, rms をそれぞれ μ, σ とすると

$$\mu = G \cdot N \qquad \sigma = G\sqrt{N} \tag{5.1}$$

と表されるので以下により PMT ゲインが求められる。

$$G = \frac{\mu}{N} = \frac{\sigma^2}{\mu} \tag{5.2}$$

Figure 5.5 には H7546 のチャンネル当たりのダークカレントの測定結果を載せた。1p.e. シ グナルは μ A のオーダーでありダークカレントは非常に小さく 1p.e. にたいして $\mathcal{O}(10^{-4})$ 程度 である。われわれの使用に際しては問題にならないレベルである。

5.5 パルスリニアリティ

すでに述べたがマルチアノードのサチュレーションは *p*/π 識別能力に影響する。粒子識別に はエネルギー損失の違いをもちいるので低エネルギー粒子が通過したときのシグナルに対して もリニアな反応が必要とされる。最終的なシンチレータ、ファイバーの組み合わせで期待され る低エネルギー陽子によるシグナルは 160 p.e. 程度と見込まれており^{*1}、3σ の統計的ふらつき を考慮して、

$$160 + 3 \times \sqrt{160} \simeq 200$$
[p.e.]

^{*1}本章にて後述。



Figure 5.4: H7546 のゲイン曲線。750Vから1000Vの領域を25V刻みで測定した。 および は1p.e. ピークからゲインを求めた もの(はhigh speed amplifier C5594 による増幅を行っている)、また はPoisson 統計 による計算から算出した。





Figure 5.6: 2-inch PMT による入射光量のモニタ。ND フィルタの透過率は回転角に たいして"exponential" で変化するので、回転角に対する ADC 値の"log" プロットは PMT の反応がリニアであれば直線になる (上図)。また下図は 式 5.2 から算出したものであるが、この式の適用範囲外の低光量領域を除 いてほぼ一定値になっており、モニター PMT のパルスリニアリティを保 証する。

High Voltage [V]	Gain	Saturation point [photoelectrons]		
		(5% non-linearity)	(10% non-linearity)	
750	1.0×10^5	400	> 600	
800	6.2×10^5	140	220	
900	2.1×10^6	60	80	

Table 5.2: マルチアノードのパルスリニアリティ測定のまとめ。各ゲインにおいてノンリニアリティが 5%および 10%となる入射光量を photoelectron 相当の量で表した。





Figure 5.7: H7546 のパルスリニアリティ。 入射光量 (p.e. 相当) ~30p.e. までの低光量入 射時のマルチアノードの出力を用いてリニア フィッティングを行った結果と、そのフィット の結果によるリニアラインとマルチアノード の ADC 値の比を取ったものを示した。5%お よび 10%のラインはノンリニアリティの目安 である。なおマルチアノードのゲインは左上、 右上、左下の順で 2.1×10^6 , 6.2×10^5 , 1.0×10^5 である。

5.6 クロストーク率

ここではクロストークの測定について述べる。まずクロストーク率の定義を以下のように 行う。

$$\mathcal{C}_i = \frac{Q_i}{Q_{sum}} \tag{5.3}$$

$$Q_{sum} = Q_{pulsed} + \sum_{neighbor} Q_j + \sum_{diag.} Q_j$$
 (5.4)

$$C_i$$
: チャン^{ネル i}へのクロストーク率
 Q_{pulsed} : LED パルスを入射しているピクセルのアノード出力電荷
 $\sum_{neighbor} Q_j$: 入射ピクセルに隣接する4つのアノード出力の総電荷量
 $\sum_{diag.} Q_j$: 入射ピクセルの最近接対角線上の4つのアノード出力の総電荷量

測定にあたりまずファイバーのアライメントを行う必要がある。H7546 のピクセルサイズは $2 \times 2mm^2$ なので、光電子の収集効率できまるクロストークの正確な評価を行うためにはピクセ ルの中心位置とファイバーの情報を知る必要があるが、 ϕ 0.7mmの波長変換ファイバーは ϕ 0.8 の穴の空いた黒アクリル製クッキーに固定されているので $\pm 50\mu m$ の精度、さらに PMT ケー スとピクセルとの相対位置も $300\mu m$ 程度の精度しかない。そこでピクセルおよびその周辺を ファイバー入射位置を変えてスキャンし、出力シグナルのマップを作ってピクセルの中心位置 を求めた (Figure 5.8)。これ以後示す図の位置座標はこのような補正を行った後のものを用い ている。





Figure 5.9: クロストーク率測定における マルチアノードのピクセルスキャン。波長 変換ファイバーを挿入・固定した黒アクリル 製クッキーを端面研磨する。このクッキー を moving stage に固定させ、ピクセル中心 を原点として X,Y 軸上で光の入射位置を変 えた。なおこのときマルチアノードガラス 面とファイバークッキーはコンタクトさせ た。クッキーのサイズはマルチアノードの 表面より大きく作っており、光漏れ等の外 部からくる光の光電面への入射はない。

印加電圧を変化させたとき

というテスト条件を変えたクロストークの測定を行っている。ファイバー径の違うデータの比較からは入射光が隣接チャンネルへ漏れることによるクロストーク、また印加電圧すなわちゲインの違うデータから dynode leak charge に起因するクロストークの評価が行える。

なお、光の入射位置がピクセル中心からずれたときの周辺8 チャンネルの ADC 分布を Figure 5.12 に示した。

測定結果

測定結果を Table 5.3, 5.4 にまとめた。まず、ファイバー径に比例して低クロストーク率の 領域が減少している。これはすなわち光電面の入射位置に依存する入射光の隣接チャンネルへ の漏れが要因である。また入射チャンネルには光電子の収集効率の低下がみられる。また表か らクロストークの High Voltage 依存性は見られない。このことより、われわれの使用するゲイ ン 10⁵ ~ 10⁶ の領域おいては、クロストークは入射位置によって光が隣接チャンネルへの漏れ てしまうことに起因するものであるといえる。

5.6.1 ファイバー径の仕様の決定

前節のマルチアノードのクロストーク率の測定結果からわれわれの検出器で使用するのに最 適な波長変換ファイバーの仕様を考察し決定する。

Figure 5.13 にクロストーク率とファイバー中心位置の許容領域の関係を示した。 ϕ 0.7, 1.0 のファイバーを用いたとき、3%以下のクロストーク率を満たすピクセルの領域はそれぞれ1161.3 μ m および 912.5 μ m、また 5%としたときはそれぞれ 1512.5 μ m および 1150.0 μ m なのでファイバー 径によるその領域の差はおのおの

 $1161.3(\pm 31.5) - 912.5(\pm 27.2) = 248.8 \pm 41.6 \mu m$

 $1512.5(\pm 31.2) - 1150(\pm 26.5) = 262.5 \pm 41.0 \mu m$



Figure 5.10: H7546 における チャンネル間クロストーク (ϕ 0.7 WLS fiber 使用時)。チャンネル 28 のピクセルにおいて、X 軸上 (上図) および Y 軸上 (下図) で ±1500 μ m の範囲をを 100 μ m 間 隔で移動させた。各ファイバー位 置 (光の入射位置) における隣接 チャンネルのクロストーク率を示 した。±1000 μ m に示した線は 1 辺 2mm のピクセル端を表す。



Figure 5.11: H7546 におけるチャンネル間クロストーク。 *φ*1.0mm の波長変換ファイバーを用いた測 定結果であり、表記は Figure 5.10 と同じである。



Figure 5.12: パルス入射位置がピクセル中心がらずれた時の周辺チャンネルの ADC 出力。図はチャンネル 29 のピクセル中心からから X 方向 (チャンネル 28 方向) へ 500µm ずれたときのものであり、チャンネル 28 からクロス トーク信号が見られる。

		測定 1(ch29)		測定 1(ch29) 測定 2(ch		(ch43)
	allowed level	$\phi 0.7$	ϕ 1.0	$\phi 0.7$	ϕ 1.0	
X region	< 3%	$^{+0.4}_{-0.5}$	$^{+0.2}_{-0.5}$	$^{+0.9}_{-0.6}$	$^{+0.7}_{-0.6}$	
	< 5%	$^{+0.5}_{-0.6}$	$^{+0.4}_{-0.6}$	$^{+1.0}_{-0.7}$	$^{+0.8}_{-0.7}$	
Y region	< 3%	$^{+0.4}_{-0.7}$	$^{+0.4}_{-0.4}$	$^{+0.5}_{-0.5}$	$^{+0.4}_{-0.4}$	
	< 5%	$^{+0.6}_{-0.9}$	$^{+0.5}_{-0.5}$	$^{+0.6}_{-0.6}$	$^{+0.5}_{-0.5}$	

Table 5.3: H7546のクロストーク測定の結果。表はクロストーク許容率を3%および 5%としたとき、その要求を満たすファイバーの設定位置領域 (mm) を表 す。例を挙げると、表中の左上の $^{+0.4}_{-0.5}$ という表記は、(ピクセル中心を原 点とした座標で) X 軸上を ϕ 0.7のファイバーを用いてスキャンしていった とき、-0.5mm~+0.4mmの領域では周辺チャンネルのクロストーク率が 3%以下に抑えられることを意味する。なお測定は入射チャンネルを変え て 2 度行った (測定 1,2)。

		測定 1(ch29)		測定 2	(ch43)
	allowed level	800V	900V	800V	900V
X region	< 3%	$^{+0.4}_{-0.5}$	$^{+0.3}_{-0.5}$	$^{+0.9}_{-0.6}$	$^{+0.9}_{-0.6}$
	< 5%	$^{+0.5}_{-0.6}$	$^{+0.5}_{-0.6}$	$^{+1.0}_{-0.7}$	$^{+1.0}_{-0.7}$
Y region	< 3%	$^{+0.4}_{-0.7}$	$^{+0.4}_{-0.8}$	$^{+0.5}_{-0.5}$	$^{+0.5}_{-0.4}$
	< 5%	$^{+0.6}_{-0.9}$	$^{+0.5}_{-1.0}$	$^{+0.6}_{-0.6}$	$^{+0.5}_{-0.6}$

Table 5.4: クロストークの High Voltage 依存性の測定結果。 *φ*0.7 の波長変換ファイ バーを用いて印加電圧を 800V,900V のときのクロストークを測定したも のであり、表の表記は Table 5.3 と同じである。ゲインによるクロストー ク率の変化は見られない。測定は異なるチャンネルで2度行っている。

となっており、ともにファイバー径の差 300µm と同程度だけその領域が狭くなる^{*2}。クロス トークは入射光がピクセル中心からずれることによる隣接チャンネルへの光の漏れであるので、 ファイバー径に応じてその許容領域が狭くなっているのが定量的に理解できる。われわれは、 ファイバーが太いほうが得られる光量が大きくなるのでファイバー径は 1.5mm を用いること にした。入射光量が大きくなることにより、Poisson 統計のふらつきに起因するエネルギー分 解能の改善が期待される。

次に 1.5mm 径のファイバーを用いるときクロストークを 3%以下に抑えるに求められるマル チアノードピクセルと波長変換ファイバー間のアライメント精度を考察する。Figure 5.13 から ϕ 1mm のファイバーを用いる時にクロストーク率を 3%以下に抑えるためにはピクセル中央の 912.5 μ m の領域にファイバー入射位置を定めなければならないことが分かる。1.5mm 径のファ イバーを用いるときにこの領域は、ファイバー径の違い分 (1.5mm-1.0mm) だけ狭くなると考 えられるので

$$912.5\mu m - (1.5mm - 1.0mm) = 412.5\mu m$$

となる。われわれはピクセル中心から $\pm 200 \mu m$ の精度でのファイバーのアライメントを行わ なくてはならない。これに対して、ファイバーとマルチアノード接続部のアライメントシステ ム^{*3}を開発した。このシステムを用いてアライメントを行い、 ϕ 1.5mm のファイバーを使用時 のクロストーク率の測定を行ったが、結果は 3%という期待通り数字が得られている。

なお、クロストークの問題のみを考えるとチャンネル当たり ϕ 0.7mm のファイバー 2 本を用いることも考えられたが、波長変換ファイバーのシンチレーション光に対する吸収量がそのファイバー径に比例する結果 [16][17] が得られており、一方その吸収量はファイバーの本数に比例しないので 1 チャンネルに付き ϕ 1.5mm ファイバー 1 本を用いることにした。

5.7 チャンネルユニフォーミティ

一つのマルチアノードパッケージ内の各ピクセルにパルスを入射したとき、同一の入射光量 にも関わらず各チャンネルごとにそのアノード出力のばらつきがある。これは各チャンネルご とにゲインが異なるためであり、数サンプルの測定結果によるこのゲインのばらつきは、ゲイ ン最大のチャンネルに対する最小のチャンネルの比を用いてあらわすと 40 ~ 60 %程度であっ

^{*2}ガウス分布を仮定し、誤差を算出した。

^{*3}このファイバー、ピクセル間のアライメントのために我々はマルチアノードのパッケージを修正した H8804 を 用いるが、PMT 及びベース回路に変更はなく H7546 と同じ性能である。



Figure 5.13: クロストーク許容領域の分布。クロストークの測定結果を用いて、許容 クロストークレベルを指定したときにその条件を満たすピクセル内の領 域の大きさの分布を示した。図は使用したファイバー径、クロストーク の許容レベルで場合分けしてある。

た。測定は ϕ 0.7mm の波長変換ファイバーを用いて各ピクセルの中心に光を入射、サチュレー ションのない 30p.e. 相当の光量に調整してある。Figure 5.14 に一例を示す。なお各チャンネル 間の相対的なゲイン比は印加電圧を変えても変化しない。

8	95	88	89	95	95	91	85	74
7	100	76	81	79	86	88	92	79
6	89	67	67	68	71	77	85	76
5	79	65	64	63	6 3	71	71	75
4	83	64	62	63	63	70	78	77
3	82	63	64	68	68	78	81	73
2	92	78	77	79	76	83	84	72
1	88	86	91	98	94	84	79	6 3
	1	2	3	4	5	6	7	8

Figure 5.14: H7546のチャンネルユニフォーミティ。全64チャンネルのゲインを、最 も高いゲインのチャンネルを100と規格化して表した。このマルチアノー ドのユニフォーミティは60%程度である。

5.8 時間分解能

マルチアノードの時間分解能に関しては以下のような測定を行った。2m 強の波長変換ファ イバーに対して LED 光の当てる位置を変えていき、アノード出力を弁別、TDC で時間分布を 測定した。TDC のスタートは LED を光らせるパルスのタイミングである。

Figure 5.15 はこの測定のセットアップの概略図とその各位置での得られたシグナルの時間分 解能を示したものである。LED 光の照射位置がマルチアノードから離れてゆくと時間分解能 が悪くなっていく。これはファイバー内の伝搬距離が長くなると減衰により光子数が減ってア ノード出力のパルス高が低くなり、threshold 付近でのジッターが大きくなるためであろう。

なおマルチアノード自体の時間分解能を評価するには照射位置がマルチアノードから最も近 いデータ点を用いればよい。4 チャンネルの測定ですべて 250ps 以下の分解能である。

5.9 考察およびまとめ

シンチレータトラッカーにおける波長変換ファイバーの読み出し用の光検出器として、マル チアノード光電子増倍管 H7546の基本特性の評価を行った。その測定結果をまとめ、考察をお こなう。



低ゲインでの使用は MIP シグナル検出時の S/N 比が悪くなる

以上を考慮してチャンネルあたりのゲインが 5×10^5 以上になるように設定する (~800Vの印加電圧)。これにより最大ゲインのチャンネルは 1×10^6 になるが、そのようなチャンネルでも ~160p.e. までは 10% ノンリニアリティで測定が行える^{*4}。

なお今回の測定は0.7mm 径のファイバーを用いたが、実機で導入する1.5mm のものを使用 するとパルスリニアリティは改善するものと思われる。一般的に光電子増倍管のノンリニアリ ティをもたらす原因は空間電荷効果であり、蓄積された空間電荷が電子の軌道に影響を与え、 電子の収束性を悪くする。しかし、同じ入射光子数でもファイバー径を太くするとその光子密 度、さらには電荷密度が低下するのでパルスリニアリティは良くなると期待される。

最後にダークカレントに関しては 0.1µA 以下、また時間分解能は 1ns 以下であり、われわれ の使用に関しては問題ない大きさである。

 $^{^{*4}}$ Table 5.2 からゲイン 2.1 × 10⁶ での 10% ノンリニアリティ点が 80p.e. であり、ゲインが半分になるとサチュレーション点はおよそ 2 倍になると考えられる。

Chapter 6

VA/TAフロントエンドエレクトロニク スの開発

マルチアノード光電子増倍管 H7546 はコンパクトかつ高性能な光検出器ではあるが、物理 の要請から我々の検出器においては幾分低いゲインでの動作が強いられる。そのために既存の PMT 読み出しではなく、新たな低レベルシグナル読み出し用エレクトロニクスを開発すると ともにコストのかかる膨大な読み出しチャンネルを削減するためのフロントエンド部でのシリ アル化を必要とする。またそのフロントエンド部自身もコンパクトなものでなくてはならない。 これらの要請に対して VA/TA チップの基本性能評価をおこない、シンチレータトラッカー

のための VA/TA 搭載フロントエンドエレクトロニクスを開発し、またマルチアノードの読み 出しエレクトロニクスに対する新たな手法を確立した。

6.1 VA32_HDR11+TA32CG

VAとはそもそも CERN(欧州合同素粒子原子核研究機構) において vertex detector にて用い られるシリコンスストリップ検出器などの小信号の読み出しのためのフロントエンド LSI(Large-Scale Integrated circuit) として開発された ASIC(Aplication Specific Integrated Circuit) で ある。VA は CMOS 回路により構成されており、マルチチャンネルの入力ラインに対して各々 charge sensitive preamplifier, slow shaper, sample&hold の回路を構成する。最後段にアナロ グマルチプレクサがあり、最終的にマルチチャンネルの入力が1チャンネルにシリアル化され、 電圧として出力される。この電圧が各チャンネルの電荷量に対応、すなわちエネルギー情報と なる。

また TA は fast triggering 機能を備えた ASIC である。VA 同様マルチチャンネルの入力に対 し fist shaping を行い、level sensitive discriminator によりトリガーシグナルを作る。この後段 に OR 回路があり、最終的には全チャンネルのトリガーシグナルの OR が出力される。

われわれは VA と TA の機能をまとめてひとつのパッケージにした IDEAS 社の "VA32_HDR11 +TA32CG(Figure 6.1)"をマルチアノード光電子増倍管の読み出しに応用し、新検出器のフロ ントエンドエレクトロニクスを開発した。この VA/TA は 32 チャンネル入力であり、1 つのマ ルチアノード PMT(64 チャンネル) に対して 2 チップ用いる。デイジーチェインで用いること により 1 つのチップとしてコントロールすることができる。この VA/TA ASIC の基本特性を Table 6.1 に示す。

^{*3}Thin Quad Flat Package、IC パッケージの 4 辺からリードピンを引き出した、高密度表面実装用のパッケージ形態。実装面積の制限から、我々は最終的にこのパッケージタイプのものを選択した。



Figure 6.1: TQFP^{*3}タイプの VA32_HDR11+TA32CG。中に見える 2 つのコアが VA と TA(上が VA、下が TA)。

VA				
プロセス	$0.8\mu m$ N-well CMOS, double-poly, double metal			
供給電圧	VDD=+2.5V, VSS=-2.5V			
slow-shaper σ peaking time	0.8 ~ 1.2µs の範囲で可変			
入力ダイナミックレンジ	$-35 \mathrm{pC} \sim +25 \mathrm{pC}$			
消費電力	73.6mW (チャンネル当たり 2.3mW)			
ゲイン	$5.8 \mathrm{mV/pC}$			
	$36\mu A/pC$ (マルチプレクスされた出力)			
ТА				
プロセス	$1.2 \ \mu m$ N-well CMOS, double-poly, double metal			
fast-shaper \mathcal{O} peaking time	75 ~ 150ns の範囲で可変			
消費電力	30mW (チャンネル当たりは 0.9mW)			

Table 6.1: VA32_HDR11+TA32CG specification

6.2 VA/TAの入出力信号およびバイアスパラメータ

VA/TAには多くの入出力信号およびバイアスパラメータが存在する。Figure 6.2 に VA/TA の構成と主な信号名を示したが、後文でも多く現れるこれらの信号名の簡略な説明を以下に 行う。



Figure 6.2: VA/TAの基本構成

6.2.1 入出力信号リスト

VA/TA の入出力信号は、32 のアナログ信号の入力ラインとそれらがシリアル化された出力、 TA のトリガー出力と VA/TA の読み出し動作をコントロールものからなる。Table 6.2 にその 一覧を示す。

6.2.2 バイアスパラメータのリスト

Table 6.3 は VA/TA の特性を決めるバイアス電流、電圧の一覧である。われわれは各バイ アスパラメータを使用にあわせて各々最適化し、フロントエンドボード上の抵抗分割で作り出 す定電流、定電圧でそのパラメータを固定する。なお、トリガー threshold のみは外部から調 節可能にする。

入出力信号名	説明	シグナルタイプ				
VA						
in[0-31]	VA へのシグナル入力ライン (32 系統)	charge				
hold_b, hold(dummy)	sample & hold 回路のホールド信号	logical				
shiftin_b	VA のシフトレジスタを初期化するための信号	logical				
clock(dummy), clock_b	VA 読み出しクロック	logical				
outp, outm	マルチプレクサのアナログ差動出力	current				
dreset, dreset_b(dummy)	VA の内部コントロールの初期化	logical				
cal	テスト信号の入力ライン	charge				
teston	テスト信号の入力ラインの有効化	logical				
TA						
ta,tb	トリガー出力 (差動信号)	current				
clkin, clkin_b(dummy)	TA 内部レジスタへ書き込みクロック	logical				
regin	TA 内のレジスタへの入力ライン	logical				
regout	TA 内部レジスタの出力ライン	logical				

 Table 6.2: VA/TA の入出力信号一覧。差動信号で dummy と表記したものは VA/TA の内部動作には寄与しない。なお "_b" と記した信号は low active である ことを意味する。

バイアス名	説明	タイプ				
	VA					
pre_bias	pre-amplifier のバイアス電流	current				
vfp	pre-amplifiers のフィードバック抵抗のコントロール	voltage				
sha_bias	shaper-amplifiers のバイアス電流	current				
vfs	shaper-amplifiers のフィードバック抵抗のコントロール	voltage				
ibuf	output-buffer のバイアス電流	current				
TA						
sbi	shaper-amplifiers のバイアス電流	current				
twbi	トリガー出力の信号幅調整	voltage				
vfs	shaper-amplifiers のフィードバック抵抗のコントロール	voltage				
vthr	discriminator $\boldsymbol{\sigma}$ threshold	voltage				
gbi	ゲインステージのバイアス電流	current				
refbi	trim-DAC のバイアス電流	current				

Table 6.3: VA/TA のバイアスパラメータ一覧。

6.3 VA/TAの読み出し原理

まず VA/TA を用いた読み出し原理を Figure 6.3 に沿って説明する。



Figure 6.3: VA/TA 読み出しの基本動作。ホールドされた全 32 チャンネルのシグナ ルが 1 つのシリアル化された出力 "outm(outp)" になる。なお、図中の slow-shaper の波高と outm の波高は、outp が電流出力であるため厳密に は同じではないが、その shaper の波高に比例した outm の出力が得られ る。また各信号の色分けは赤がアナログ (下線付き)、青がデジタル信号 であることを示す。

ある物理イベントによる入力信号はまず pre-amplifier によって増幅される。この増幅信号は 2 系統に分割され、各々VA および TA の shaper への入力となる。VA, TA に関してシグナルの 流れは以下の通りである。まず VA については、

[1] slow-shaping

pre-amplifier によって増幅されたシグナルは slow-shaper を通り、charge \rightarrow voltage 変換 がなされる。shaper の peaking time は 1 μ s 程度でありゆっくりした立ち下がりの出力信 号である (Figure 6.4)。

[2] sample & hold

slow-shaper の後段に sample&hold 回路があり、外部からの"hold_b" シグナルによって 全 32 チャンネルの slow-shaper のパルス高が保持される。("hold_b" が low から high へ 戻ると、このシグナルのホールドは解除される。)

[3] mutiplex

保持された各チャンネルの信号はマルチプレクサによってシリアル化される。マルチプ レクサの信号切り替えはシフトレジスタで行い、"shiftin_b"が low のときの読み出しク ロック ("clock_b") 立ち下がりエッジでスイッチは初期化されてチャンネル0 につながる。



[3] wire-or circuit

各チャンネルの終端は pull-down されて OR 回路に接続される。各々の信号の OR をとることによりチップ共通のトリガーシグナルとなる。なお最終的な出力は VA と同じく差動電流出力となり、それぞれ "ta", "tb" と呼ぶ。

以上により電荷情報、時間情報となる VA, TA の信号が得られる。ここでは触れなかった TA の機能に gain stage による shaper 出力を増幅、またトリガーチャンネルのマスク機能があり、 シフトレジスタによるチャンネルごとのトリガーの有効化 · 無効化の切り替えが可能である。こ れらのレジスタの書き込みは" regin" およびその書き込み用クロック" clkin" で行う。

また、64 チャンネル出力をもつマルチアノードの読み出しには 2 つの VA/TA チップ (32×2 チャンネル) 必要である。この 2 チップの使用法した読み出しは次の通りである。あるイベン トに対して TA のトリガー信号を検出し、2 チップの"hold_b" を low にして全 64 チャンネルの 信号をホールドする。まず前述のように 1 つめのチップを読み出す。このチップの"shiftout_b" を 2 つめのチップの"shiftin_b" に用いてさらに読み出しクロックを送り続けると、2 つめの VA の読み出しシーケンスが実行される。すなわちチップ 1 への"shiftin_b" と両チップ共通に 64 ク ロックを送り、外部回路でチップ 1, 2 の VA 出力を共通にすることによりマルチアノードの 64チャンネルの出力のパラレル・シリアル変換が行える。なおマルチプレクサに対する 33 個目の クロックから各チャンネルへのスイッチは無接続 (NC) となるのでチップ 1, 2 の VA 出力の衝 突はない (Figure 6.5)。



Figure 6.5: 2 チップを用いた読み出しシーケンス。動作説明は本文に記述してある。

6.4 VA32_HDR11+TA32CGの性能評価

われわれは VA/TA を用いたマルチアノード読み出し用フロントエンドボード開発にあたり、 まずプロトタイプの製作を行った。この VA/TA プロトタイプフロントエンドボードを用い、 VA32_HDR11+TA32CG の動作評価、マルチアノードのシグナル読み出しの確認、パラメータ の最適化等を行い、実機に導入するフロントエンドボードを開発した。

最終的な VA/TA を用いた読み出しの評価は VATA フロントエンドとその読み出し回路も含めたものでなくてはならない。今章で触れない多くの評価は、次章で実機に導入するフロント エンドボードとその読み出し用モジュールとあわせて行う。

そこで本節ではこのプロトタイプフロントエンドボードを用いた VA/TA の性能評価および マルチアノード読み出しの研究、最終デザインに向けて行った考察をまとめる。

6.4.1 VA/TA プロトタイプフロントエンドボード



Figure 6.6: VA/TA プロトタイプフロントエンドボード

Figure 6.6 に示したのはシンチレータトラッカーのための VA/TA フロントエンドとして製作したプロトタイプボードである。PGA(Pin Grid Array) タイプの VA/TA ^{*4}を2チップ搭載し、またマルチアノードはノイズ源となる浮遊容量などを極力小さくするためにフロントエンドボード中央に直接マウントできるようにして VA とアノード間の距離を短くしている。

なおこのフロントエンドボードの読み出しには VA の読み出しシーケンス制御、およびアナロ グ出力の AD 変換のための外部回路が必要であるが、この段階では次章に述べる DAQ module は未開発である。PPG(Pulse Pattern Generator)を用いて Figure 6.5 に示したような固定パ ターンを生成し、ラインドライバを通して±2.5Vの VA/TA コントロール信号をつくり、読み 出しシーケンスを実行する。またアナログ出力の読み出しに関しては"VA-DAQ"と呼ばれる IDEAS 社の VA ASIC 評価用のデータ収集システムを用いている。

6.4.2 VA/TA フロントエンドエレクトロニクスに課せられる要求

性能評価をおこなう前にまず、このフロントエンドエレクトロニクスでの読み出しに課せられる要求を挙げる。

 $^{^{*4}}$ 最終的に使用するパッケージは TQFP であるが、 VA/TA の性能自体は同じものである。

【1】MIP シグナル (7-20p.e.) に対して十分小さいノイズレベル

【2】200p.e. 相当の入力信号までのダイナミックレンジを有する

【3】低いチャンネル間クロストーク率

【4】~10nsのトリガーシグナルの時間分解能

【5】低いトリガー threshold 値 (1p.e. 以下)

[6] VA slow shaper \mathcal{O} peaking time $\ddagger 1.2 \mu s$

【7】 VA および TA 出力の 4m ケーブル使用時のドライブ能力

【1】【2】に関しては前章マルチアノードの箇所ですでに触れたが、シンチレータトラッカーの基礎性能(粒子識別、運動量測定)から必要とされるものである。またクロストークの存在は粒子の飛跡検出の際のバックグラウンドとなる【3】。マルチアノードのクロストーク率が3%なのでこれより十分低いことが求められる。

【4】に関してはの K2K のビーム構造からくる要請である。前章でも述べたが、ビームスピ ルは 1.1µs、1 スピルは 9 バンチ (バンチ幅は約 50ns)の構造をもっており、解析時にニュート リノビームに起因するイベントと宇宙線などのバックグラウンドを区別するためにはこのバン チ構造を識別できるだけの時間分解能をもたねばならない。われわれ検出器においてはシンチ レーション光および波長変換ファイバーの吸収・再発光の過程が時間分解能を決定する (~10ns) ので、読み出し用エレクトロニクスに対してはマルチアノードと同程度の~1nsの時間分解能 を要求する。

【5】は、われわれの検出器がセルフトリガーでの動作を必要とするためである。トリガー 検出効率を上げるためには十分低い TA threshold でもノイズヒットなく動作することが必要 とされ、また TA の時間情報は粒子の飛跡およびイベント再構成の際の付加的な情報になる。 threshold 値は 1p.e. 以下に設定できることが望ましい。

【6】に関してもほぼ同様で、マルチイベントを識別するために TA のノイズヒットを無くす ためであるが、詳細は 6.4.6 節で述べる。【7】は検出器の構造により、フロントエンド部と後 章で述べる VA/TA をコントロールする DAQ module の接続に 4m のケーブル長が必要となる ためである。

入力信号の表記について

前章でマルチアノードの性能についてまとめたが、われわれの期待する検出器性能を得るためには5×10⁵ ゲインでのマルチアノードの使用が求められ、読み出し用エレクトロニクスにおいてもこのゲイン値での使用を想定して開発している。以後入力信号の電荷量を photoelectron 相当の表記を用いるが、

1p.e.シグナル = (電子の電荷量) × (マルチアノードのゲイン)
=
$$(1.6 \times 10^{-19} \text{ [C]}) \times (5 \times 10^{5})$$

= 0.08 [pC]

の関係がある。

6.4.3 VA のチャンネル間クロストーク

Figure 6.7 に示したのは VA のクロストーク率である。ひとつのチャンネル (図ではチャン ネル 13) に MIP 相当 0.8pC のシグナルを甘 ルを衫 蘭芦 ^_未とfl 蘊犟 V ルを 鰨 重 粦 『 養厉 ¥ 黨窡 魫 !!



Figure 6.8: DC カップリング時にお ける VA の vfp 依存性。マルチアノー ドと VA を DC カップリングで結合し、 vfp の設定値による出力の変化を測定 した。各データ点での VA への入力周 波数および電荷はそれぞれ、()LED 100Hz, 0.8pC(10p.e.)相当、()LED 10Hz, 0.8pC 相当、()LED 100Hz, 5pC 相当、であるがプラトー領域に 周波数特性が見られる。なお、(×)は 100Hz、AC カップリングにて 4.8pC テストチャージを VA に入れた時のも のであるが、この測定領域では出力電 位に変化はなく安定であった。

ことは pre-amplifier のゲインを上げることに対応し、ある値より小さくするとフィードバック によるゲインへ変化がなくなり、出力は一定になる (プラトー領域のようになる)。このプラトー 領域は 100Hz の時の方が狭く、また光量を上げて VA への入力電荷量を大きくしてもその領域 に変化はない。

このような原因としてはテイルパイルアップのような効果でベース電位がさらに下がってしまいフィードバックの効果が変化しているものと考える。DCカップリングの際ベース電位を測定すると-200mV程度であり、前章の測定により、H7546のダークカレントは非常に小さいのでアノードが有限の電位をもつと考えられる。これはマルチアノードH7546の出力ピンが直接アノードにつながっており^{*5}(Figure 5.1)、LED照射の周波数が上がるとこれに応じてアノード電位が変化するからであろう。このような効果で周波数特性が現れると推測する。

また VA チップがデッドチャンネルを有する時にその出力レベルが不安定になる現象が見られた。入力インピータンスが大きくなった VA のデッドチャンネル^{*6}には放電の経路がなくてア ノードがチャージアップするとともに、そのチャージアップしたチャンネルによって他のチャ ンネルのアノードの電位を変えてしまったと考えられる。

まとめると、

- VA ゲイン (vfp)の周波数特性の改善
- VA にデッドチャンネルが生じたときのアノードのチャージアップの防止

以上のためにはアノードをターミネーションしなくてはならない。またアノード出力のシグナ ル伝搬のためには VA 入力のラインをキャパシタでデカップルする必要がある。なおこのよう な使用で、DC カップリングの時のような周波数特性は見られなかった。

 $^{^{*5}-}$ 般的に光電子増倍管のアノードはそのベース回路にて $100 \mathrm{k}\Omega \sim \mathrm{M}\Omega$ オーダーの抵抗でターミネーションされている。

 $^{^{*6}}$ VA の入力インピータンスは低く、測定によると $30\sim40\Omega$ 程度であった。

ゆえにわれわれは、マルチアノードと VA の結合は AC カップリングにすることにした。な おカップリングパラメータは、VA の amplifier の時定数より短くなる、PMT 出力が微分され ない、という条件の下 100kΩ, 100pF に決定した。

6.4.5 TA の時間分解能

ここでは TA の時間分解能測定の結果をまとめる。

TA 出力は検出器における粒子のヒットタイミングとして記録されるとともに、トリガーと なって VA slow-shaper のホールドタイミングを決めるので、その時間分解能が求められる。TA はカレント出力であり、そのシグナルのレシーブ方法によってケーブルのドライブ能力、時間 分解能が変わってくる。われわれは voltage comparator を用いたレシーバ回路をつくり、実機 で使用するよりおよそ倍長い 10m のフラットケーブルを用いて TA のシグナルドライブ能力お よびシグナルのジッターを測定した (Figure 6.9)。ジッターは 246.5ps という測定結果であり、 このような使用であればケーブルドライブ能力は問題ない。時間分解能に関しては今回は測定 を行ってないが、0.4p.e. 相当の threshold でトリガー検出可能 (Chapter 7 にて述べる) である 結果を得ているので Q 依存性がない、十分な時間分解能が得られると期待している。



Figure 6.9: TA のレシーバ回路 (左図) とジッター (右図)。TA レシーバ出力の立ち下 がりエッジをオシロスコープで確認した。右図上方に見えるヒストグラ ムは出力パルスの時間的ふらつきを表す。

6.4.6 トリガー検出についての考察

トリガー検出については後の Chapter7 にて触れるが、ここでは TA 出力とコントロールシグ ナルについて述べる。われわれの検出器においてはセルフトリガー動作が求められ、トリガー 検出効率をよくするためには threshold を低く設定することが必要である。TA の出力信号は TMC(Time Memory Cell, マルチヒット TDC) によりヒットタイミングが記録され、粒子のト ラッキングを行う際の付加的な情報となる。

Figure 6.10 は threshold に 1p.e. レベル以下に設定したときの TA 出力と各コントロールシグ ナルの様子をオシロスコープで確認したものである。threshold 値は数 mV であり、+2.5V↔- 2.5V のコントロール系のシグナルドライブに起因するノイズトリガーが見受けられる。これにより、実機での動作に関して以下のような問題が生じることが想定される。

- ニュートリノマルチイベントとの誤認識
- ノイズヒットによる偽データと不感時間の増加

前者は、K2K のビームスピル幅が $1.1\mu s$ であるためあるニュートリノイベントに対してその後 $1.1\mu s$ 以内の TA 出力はビーム起源のマルチイベントと解釈されうる問題である。この解決策と してはノイズヒットとなりうるコントロールシグナルをビームスピル中は静止させておくこと であるが、このタイミングで問題となるのは" hold_b" である。VA slow-shaper の peaking time は ~ $1\mu s$ であり、トリガー検出時より $1\mu s$ 後に hold 信号を送るが、この hold によってノイズ ヒットが生じる可能性があるので hold 信号のタイミングをスピル幅 $1.1\mu s$ より長くする必要が ある (~ 1.2μ m)。またこれに伴い slow-shaper の peaking time を $1.2\mu s$ に調整するようなバイ アス調整を行う。

また後者に対しては、読み出しのアルゴリズムを考慮することに解決できる。幸いコントロール系以外の信号に同期したものやランダムな TA 出力は見られない。読み出しシーケンス実行中におけるトリガー検出に対して inhibit をかける^{*7}が、この inhibit 解除をコントロール信号の変化時から TA fast-shaper のパルス幅より十分長い数 100ns~1µs 後に設定すればよい。

^{*7}後章にて述べるが、トリガー検出に制限をかけることは TA の検出自体を行わないことを意味するものではない。TA レシーバの出力はトリガー検出用、TMC 入力用の 2 系統に分けられ、そのヒット情報は記録される。なおコントロール信号によるノイズヒットはそのタイミングが決まっているためその時間分布を見るとピークになり、これをマスクすることは可能である。



6.5 VA/TA プロトタイプフロントエンドボードを用いたビームテス トでの動作評価

前述まで述べてきたようなテストベンチでのプロトタイプのデバッグ作業、その他 VA/TA のバイアスパラメータなどの最適化を行い、われわれは高エネルギー加速器研究機構 12GeV 陽 子シンクロトロンの T1 ビームライン (Figure 6.11) にて VA/TA プロトタイプフロントエンド ボードを用いたビームテストを行った。このビームテストの主要な目的は

- インテグレートされた検出器システムでの動作確認
 - (シンチレータ)+(波長変換ファイバー)+(マルチアノード光電子増倍管)のシグナル 読み出しによるエネルギー測定
 - charge sensitive ADC との性能比較
- 実使用条件下でのノイズ評価
- 実機に導入するフロントエンドボード製作へのフィードバック

などである。以下にその測定結果をまとめる。



Figure 6.11: KEK-PS のビームライン。図中の T1 ビームラインにて測定を行った。 1 次陽子ビームの Internal Target への衝突によって生成される p, π ビームを用いる。得られるビームの最大運動量は 2GeV/c。

6.5.1 テストセットアップ、トリガーロジック

T1 ビームライン上のテストセットアップの概略を Figure 6.12 に示すとともに以下にその説 明をする。

 TOF カウンタ 1,2: ELJEN Technology 製の decay constant ~ 1ns 以下の高い時間分 解能をもつプラスチックシンチレータの両端に光電子増倍管が取り付けられたものであ り、TOF(Time of Flight)の測定から p, π の粒子識別を行う。2 つのカウンタ間の距離は 330cm である。

- Finger カウンタ 1,2:シンチレーティングファイバーのバンドルを 1-inch PMT に接着 したもの。幅の狭いカウンタであり、ビーム位置の定義を目的として使う。
- シンチレータトラッカー(ミニチュア版):幅20mm、厚さ10mmのシンチレータで作ったシンチレータトラッカーのプロトタイプ。シンチレータを5本並べたものを1レイヤーとし、X軸方向、Y軸方向にセグメント化されるように交互に並べる。各シンチレータの場所の表記には図中に記したように、X方向にセグメント化されたレイヤー(Xレイヤー)のうち、上流から2つ目のレイヤーの左端はX2-1という表現を用いる。使用した波長変換ファイバーはKuraray製Y11-200MS(φ1.0mm)である。Xレイヤー、Yレイヤーの読み出しにはMAPMTH7546を各々ひとつずつ用いているが、その信号読み出しはXにはVA/TA(プロトタイプフロントエンドボード)、Yにはcharge sensitive ADCを用いた。
- なお、トリガーロジックの概略図も Figure 6.13 に示した。



Figure 6.12: ビームテストセットアップの概略図。上流に設置された 2 つの TOF カウンタにて p/π の粒子識別を行い、検出器直前におかれた Finger カウンタでビームサイズを決める。

6.5.2 VA による読み出しと charge sensitive ADC によるものとの比較

charge sensitive ADC を用いた読み出しと VA を用いたデータを比較することによりその動作、アナログ性能を評価する。VA によるもと charge sensitive ADC による読み出しは検出器 チャンネルが違うので、比較のための同じ条件を課すために以下のような事象選択した。

- シンチレータに対して粒子が垂直に突き抜けたイベントのみを選択。
- 突き抜けの定義は X1-3 ~ X5-3, Y1-3 ~ Y5-3 すべてに粒子がヒットしており、他のチャンネルにはヒットがない。
- ヒットあり、なしの定義はシグナルがペデスタルの分布から 3σ離れているか、あるいは 以内であるかとした。


Figure 6.13: ビームテストにおけるトリガーロジックの概略図。ビームライン上のカ ウンタからのシグナルの coincidence がトリガー信号となる。各カウン タのシグナルは ADC および TDC でエネルギー情報と時間情報を記録す る。また、検出器のマルチアノードの読み出しには CAMAC と VA-DAQ を用い、それぞれ異なる PC を用いる。この2つの読み出しによるイベ ントの同期をとるために Event Lam Resister(ELR) と VA-DAQ の busy 出力を用いてトリガー検出 (coincidence モジュール) に veto をかけた。

上記のカットによる運動量 1.2GeV/c のビームコンディションの時の垂直突き抜け事象による 光量分布の比較を Figure 6.14 に示した。事前に行ったマルチアノードのキャリブレーション データよりチャンネル間のゲインの補正は行っている。

- VA:
- (p) mean: 12.9 rms: 4.7 p.e. (π) mean: 10.9 rms: 4.7 p.e.
- CS-ADC:
 - (p) mean: 12.6 rms: 4.4 p.e.
 - (π) mean: 9.8 rms: 4.5 p.e

その分布はほぼ一致しており、VA を用いたマルチアノード光電子増倍管の読み出しで十分に エネルギー測定が可能であること、また少なくとも CAMAC charge-sensitive ADC と同程度 の性能を有するものといえよう。

6.5.3 ノイズについての評価

大規模なシステムを組み上げる際、時としてノイズが大きな問題となる。我々のシステムも 然りで、実機導入時に想定されるノイズに対策を講じておく必要がある。

データ解析時において各チャンネルのペデスタルの時間変動を追っていくと数 Hz 程度の周波 数で周期的なふらつきが確認された (Figure 6.15)。しかも全チャンネルが同期していたのでコ モンモードノイズの存在を疑った。議論に入る前にノイズの伝搬モードについてまとめておく。



Figure 6.14: VA による読み出しと charge sensitive ADC による読み出しの比較。左 2 つの図が MAPMT をプロトタイプフロントエンドを用いた読み出しに よる p および π の分布、右 2 つが CAMAC charge sensitive ADC を用 いたもの。ビーム運動量はともに 1.2GeV/c。

コモンモードノイズとノーマルモードノイズ

一般にノイズは信号の入力形態同様その伝導モードにより2つの種類に分けられる。1つは 電源ライン間、シグナルライン間に発生するノーマルモードノイズ(ディファレンシャルモー ドノイズ)である。このノイズの性質はシグナルと同じであり、ノイズ電流はそれぞれ逆方向 である。よって原理的に除去できないので各ラインにバイパスコンデンサ等のフィルタを用い て対策する。

もう一方はコモンモードノイズと呼ばれるものでシグナルライン、電源ラインとグラウンド 間に発生するものである。ノイズ電流の方向はともに同じであり、入力端子間の電位差は変わ らないために除去可能である。

コモンモードノイズの算出

コモンモードノイズの算出は以下のように行った。イベント e に対する i チャンネルのデー タサンプルを d_i^e と表記する。また総チャンネル数は N_c とする。一般的にコモンモードノイズ は低周波数であり、比べて読み出しにかかる時間は十分短いのでコモンモード d_{cm}^e は次のよう に定義される。

$$d_{cm}^{e} = \frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} d_i^{e}$$
(6.1)

全イベント N_e におけるコモンモードの平均 \overline{d}_{cm} は

$$\overline{d}_{cm} = \frac{1}{N_e} \sum_{i=1}^{N_e} d^e = \frac{1}{N_e N_c} \sum_{i=1}^{N_e} \sum_{e=1}^{N_c} d^e_i$$
(6.2)



と表され、コモンモードノイズはコモンモードの標準偏差であり、以下によって求められる。

$$\sigma^2(d_{cm}^e) = \frac{1}{N_e} \sum_{i=1}^{N_e} (d_{cm}^e - \overline{d}_{cm})^2$$
(6.3)

Figure 6.17 にコモンモードノイズの様子を示した。なお各イベントのコモンモード算出にお いては各チャンネルのペデスタル分布より 3σ 以内に位置するものだけをペデスタルチャンネ ルとして用い、3σ よりずれるものはヒットシグナルとして省いている。



Figure 6.17: ビームテストにて観測され たコモンモードノイズ。図の横軸はイベン ト番号、縦軸は ADC 値であり、イベントご とのコモンモード d^e_{cm} を示した。100 イベ ント程度を半周期とした大きなうねりが見 えるが、これがコモンモードノイズである。



Figure 6.18: コモンモードを引く前と 後のシグナル分布。Figure 6.17 のコモン モードを引くことによりペデスタルの分布 は $\sigma = 1.0$ p.e. から $\sigma = 0.3$ p.e まで小さく なる。また分布のテイルはビームイベント。

コモンモードノイズはその素性がわかっていれば原理的にオフラインで除去可能 (Figure 6.18) ではあるが、システムの信頼性の問題として対処しておく必要がある。

- シグナルライン、電源ラインへのラインバイパス
- 電源、グラウンドラインのレイアウトの考慮
- 読み出しスピードを上げる

以上のようなことがコモンモードノイズ対策として行える。実機導入するフロントエンドボード製作に対してのフィードバックとしては、フィルタリングにより電源ラインへのラインバイ パスをしてノイズ除去 (Figure 6.19) ができるように基盤レベルでの電源、グラウンドラインの デザインの考慮をする必要がある、ということである。

またなるべく高速な読み出しを行うことも、時間変動がゆっくりしたコモンモードノイズに 対しては有効である。

75



Figure 6.19: コモンモードノイズに対するフィルタリング。基盤レベルでグラウンド をいくつかに分けておき、フィルタによってノイズをバイパスして負荷 への流れを阻止する。

6.6 結論

われわれは K2K の新たな前置検出器となるシンチレータトラッカーのための 64ch マルチア ノード光電子倍管の読み出し用回路として、IDEAS 社の VA32_HDR11+TA32CG を用いたフ ロントエンドエレクトロニクスの開発を手がけた。VA/TA ASIC の基本特性の評価、プロトタ イプフロントエンドボードの製作開発、われわれの検出器にあったバイアスパラメータの最適 化、およびその後のビームテストを行い、この章ではそれらのうち重要であると思われるいく つかの事項についせ用厭ち重蓉锘タで烈 ム化犞獢猛 U 拱して 寅ヒン扌 1 *** 起S 靡 文続絨



Figure 6.20: 開発したフロントエンドボード。サイズは 170mm × 100mm。TQFP パッケージの VA/TA を両面に実装し、マルチアノード出力のアナログ ラインに鏡面対称性を持たせてある。また写真右は 2003 年 1 月に実機 にインストールされたもの。

Chapter 7

VA/TAフロントエンド読み出し用 DAQ moduleの開発

前章ではマルチアノード光電子増倍管の読 み出し用エレクトロニクスとして VA/TA フ ロントエンドボードを開発し、その性能が我々 の要求を満たすものであることを示した。しか しながらこの VA/TA フロントエンドを使用 するためには VA アナログ信号のデジタル化お よび VA/TA 読み出しシーケンス制御のための デジタルコントロール回路が必要である。この ような新検出器での DAQ(Data AcQuisition) の中核となるモジュールを比較的高速なバス 転送速度をもつ VME 規格に準じて製作した (Fig.7.1)。本章はその開発に関して報告する。



Figure 7.1: 開発した DAQ module の写真

7.1 本章の概要

本章では新たに開発した DAQ module の構成およびその動作について説明したあと、VA/TA フロントエンドボードと DAQ を用いてシンチレータトラッカーの読み出しエレクトロニクス の性能評価を行う。なおその項目は、

- パルスリニアリティ
- 各種ノイズ

トリガー検出効率

であり、おのおのについてその評価、考察を行っていく。

7.2 DAQ moduleの概要、構成

まず VA/TA フロントエンド読み出し用 DAQ module の概要について説明する。前節では VA/TA フロントエンドについて述べたが、その読み出しのためには VA のコントロールシグ ナルをタイミング制御、またアナログ出力のデジタル化等の機能をもった制御系が必要である。 このような必要性のもと、VA/TA 読み出し用の VME 規格のモジュールを製作した。40 極 のケーブルを用いてフロントエンドボードと DAQ module を接続して使用する。以下にこの DAQ module の構成を述べる。

— Flash-ADC による VA 出力のデジタル化

VA のアナログ出力 ("outp", "outm") のレシーバは 2 段の増幅器からなり、主に前段 のオペアンプで増幅率を稼ぎ、後段で差動入力信号を受けている (Figure 7.2)。なおこ の VA のアナログ信号は 4m のケーブルを伝わってくるためノイズを拾いやすいことが分 かっている。そこで入力ラインにケーブルとのインピータンス整合性のある 100Ω よりも 大きな抵抗 (150Ω ンフィギュレーションデータをロードすることによりなされ、目的にあったロジックを実現する。DAQ module の FPGA には XILINX 社製 Virtex XCV300 (システムゲート数 ~300,000) を用いた。なお DAQ モジュールの多くのコンポーネント (flash-ADC, DAC, FIFO 等) の動作制御もこの FPGA で行う。

― キャリブレーションパルスの生成回路

VA のキャリブレーションのためのテストチャージ生成回路である。12bit-DAC の 2 つ の出力ラインをアナログマルチプレクサにいれ、この入力ラインの切り替えにより welldefine なパルス高の矩形波をつくる。このパルスを"cal"におくり、VA/TA チップ直前 に設置された 22pF キャパシタを通ることにより電荷量が決まる (Q = CV)。なおテスト チャージは ~ ±88pC(± 4V × 22pC) の範囲、12bit の精度で生成可能である。

 TA(トリガー) threshold のコントロール
 Threshold の設定にも上記と同じ DAC を用いている。TA のゲインステージによりその 信号極性が変わるので両極性の threshold を設定できることが求められる。そこで DAC 出力を OP アンプを通して ±2.0V のバイポーラ出力が得られるようにした。 なお DAC を用いた" cal", "vthr" の線形性評価を Figure 7.3 に示した。これらのシグナルを基準と して以後のエレクトロニクス動作評価を行っていくがその精度は十分なものを有する。



DAQ モジュールのフロントエンドへのコネクタピンには電源供給ラインが設けられて おり、レギュレータにより作られる ± 5 V の一定電圧をフロントエンドボードに送る。フ ロントエンドボード上で VA/TA の動作電圧 ± 2.5 V に落とされる。

— フロントパネル I/O インターフェース

フロントパネル I/O インターフェースには VA/TA フロントエンドボードとの接続の ための 40 極コネクタ、LVDS 信号入力コネクタ、"external trigger", "external clock" の NIM 入力、"busy out", "TA1, TA2" (VA/TA チップ 1,2 の TA 出力) の NIM 出力であ る。LVDS 入力は我々の検出器においてはトリガータイプ (ビームスピル、ペデスタルト リガー、宇宙線トリガー等) の記録に用いている。芷覭葨蚩貧 ±



- 【2】トリガー検出により、DAQ module 内の内部カウンタが動作し始める。*T_{hold}* 後にホール ド信号 ("hold1,2(_b)") をフロントエンドに送り、slow-shaper の波高をホールドする。
- 【3】 "shiftin_b" および" clock_b" を送り、マルチプレクサのチャンネル切り替え、読み出し 開始。
- 【4】"clock_b" と位相をずらしたサンプリングクロック"adclk"を FADC に送り、VA アナロ グ出力の AD 変換。さらにデジタル化された VA 信号を FIFO に書き込む。FIFO 書き込 み用クロック"wclk"は"adclk"より半周期ずらしている。
- 【5】 "clock_b"65 クロックを送り終えて "shiftout_b" を検出、"dreset" 信号を送り VA の内部 ロジックの初期化。その後 VA の hold 解除、さらに BUSY を解除。
- 以上が簡略な動作説明である。



- 【1】"teston"を low にし、"cal"のシグナル入力ラインをアクティブにする。
- 【2】"teston"は low のままで"shiftin_b" および目的のチャンネル分だけ" clock_b" パルスを送る (チャンネルの指定は FPGA 内部レジスタの書き換えにより行う)。VA の入力および 出力のマルチプレクサ・シフトレジスタはパラレルに動作し、" cal" パルス入力チャンネルと出力部のマルチプレクサの接続チャンネルは同じ番号になる。
- 【3】DAQ module 内のテストパルス生成回路にタイミングシグナルを送り、アナログマルチ プレクサを切り替えて、あらかじめ DAC により設定されていた 2 つの入力チャンネルの 電位差に対応した波高をもつ矩形波を作り出す。
- 【4】 "cal" ラインに実装されたキャパシタで、Q = CVにより charge が生成されて VA への入力となる。
- 【5】テストパルス生成タイミング信号を送った瞬間から内部カウンタが動作し始め、 T_{hold} 後に hold 信号を出す。
- 【6】以後、hold 信号の off、FADC サンプリングおよび FIFO の書き込みを連続的に行うこと により、既知の入力電荷シグナルをもちいた VA のキャリブレーションが行える。

7.4 読み出し系の性能評価

ここまで VA/TA フロントエンドボードの読み出し用モジュールである DAQ module の仕様、動作等を述べてきた。ハードウェアのデバッグ、HDL ^{*1}デザインとその動作確認、VME バス経由でのコントロール等の確認を終えたあとに、この読み出しエレクトロニクスの性能評価を行った。

この評価は実機に導入する VA/TA フロントエンドボード、DAQ module のアナログレシー バ等のすべてのコンポーネントをインテグレートしたものに対するものである。

7.4.1 パルスリニアリティ



Figure 7.7: パルスリニアリティの測定結果。上図は横軸に VA への入力電荷、縦軸に ADC 出力をプロットし、リニアフィッティングを行ったものである。下図 のそのデータ点のリニアラインからのずれを表したものであり、300p.e. 相 当までの入力電荷に対して 5%のノンリニアリティである。なお、350p.e. 以上の入力に対してはオーバーフローとなっている。

Figure 7.7 は読み出し系のパルスリニアリティの測定結果である。"test-mode"読み出し にて VA への入力電荷を変化させた。マルチアノードのリニアリティ特性と同程度の性能を要

^{*1}Hardware Description Language の略、ハードウェア記述言語。半導体技術の進歩により何万という論理ゲートをもつ電子回路を製作可能になった現代ではレジスタレベル (RTL:Resister Transfer Level) での回路設計が必要となってくる。HDL は RTL での記述を可能にした言語であり、FPGA 等を用いた回路開発には HDL を用いて行う。

求すると、200p.e.相当の入力電荷に対してノンリニアリティは5%以下でなくてはならないが、 これに対して十分良いリニアリティを有する。読み出し用エレクトロニクスのノンリニアリティ は300p.e.の入力に対して5%である。

なお先にも述べたがマルチアノードにはチャンネル間のゲインのばらつきがあり、(最大のチャンネルゲイン)/(最低のチャンネルゲイン) $\simeq 2$ であるので低エネルギー陽子のシグナル (160 p.e., PMT ゲイン: 5×10^5)の2倍の電荷量までの入力レンジとなるように VA レシーバアンプのゲインを調節した。

7.4.2 チャンネルゲインユニフォーミティ

フロントエンドボード内でチャンネル間にどの程度のゲインのばらつきがあるかを測定した。 Figure 7.8 は test-mode 読み出しで、全 64 チャンネルについて入力電荷量を変化させてその ADC 出力をスキャンしたものである。またそのデータからチャンネルごとのゲインを求めた。

測定結果はチップ内でのゲインのばらつきは殆ど見られず、±1%でユニフォームである。しかしチップ個性があり平均チャンネルゲインはチップごとに数%のばらつきがあると思われる。

7.4.3 ノイズレベルの評価

この節では読み出し系のノイズ特性についての評価、考察を行う。

読み出し系のノイズの定義

ノイズの評価に際して以下のような量を用いた。

- チャンネルペデスタルの分布の rms の全チャンネル平均
- コモンモードノイズを引いたチャンネルペデスタルの分布のrmsの全チャンネル平均

詳細を述べると、まずコモンモードを引いた (common-mode subtracted) チャンネルiのデー タを $d^{(i)_{cms}}$ と表記するとそのイベント平均 $\overline{d^{(i)}_{cms}}$ は、

$$\overline{d_{cms}^{(i)}} = \frac{1}{N_e} \sum_{e}^{N_e} (d_i^e - d_{cm}^e)$$
(7.1)

$$= \overline{d}_i - \overline{d}_{cm} \tag{7.2}$$

と表される。 N_e, d_i^e, d_{cm}^e は 6.5.3 節で用いたものと同じであり、それぞれ全イベント数、イベント e に対するチャンネル i のデータ、イベント e のコモンモードであり、また $\overline{d}_i, \overline{d}_{cm}$ はチャンネル i 及びコモンモードの全イベント平均である。

この量を用いると $d_{cms}^{(i)}$ の標準偏差は

$$\sigma^{2}(d_{cms}^{(i)}) = \frac{1}{N_{e}} \sum_{e}^{N_{e}} \left(d_{cms}^{(i)} - \overline{d_{cms}^{(i)}} \right)^{2}$$
(7.3)

$$= \frac{1}{N_e} \sum_{e}^{N_e} \left((d_i^e - d_{cm}^e) - \left(\overline{d_i} - \overline{d_{cm}} \right) \right)^2$$
(7.4)

$$= \frac{1}{N_e} \sum_{e}^{N_e} \left(\left(d_i^e - \overline{d_i} \right) - \left(d_{cm}^e - \overline{d_{cm}} \right) \right)^2$$
(7.5)

7.4. 読み出し系の性能評価



$$= \frac{1}{N_e} \left(\sum_{e}^{N_e} \left(d_i^e - \overline{d_i} \right)^2 - 2 \sum_{e}^{N_e} \left(d_i^e - \overline{d_i} \right) \left(d_{cm}^e - \overline{d}_{cm} \right) + \sum_{e}^{N_e} \left(d_{cm}^e - \overline{d}_{cm} \right)^2 \right) (7.6)$$

$$= \sigma^{2}(d_{i}) + \sigma^{2}(d_{cm}) - \frac{2}{N_{e}} \sum_{e}^{N_{e}} \left(d_{i}^{e} - \overline{d_{i}} \right) \left(d_{cm}^{e} - \overline{d}_{cm} \right)$$
(7.7)

であり、common-mode subtracted データの標準偏差のチャンネル総和は

$$\sum_{i}^{N_{c}} \sigma^{2}(d_{cms}^{(i)}) = \sum_{i}^{N_{c}} \sigma^{2}(d_{i}) + N_{c}\sigma^{2}(d_{cm}) - \frac{2}{N_{e}} \sum_{e}^{N_{e}} \left(\sum_{i}^{N_{c}} \left(d_{i}^{e} - \overline{d}_{i}\right)\right) \left(d_{cm}^{e} - \overline{d}_{cm}\right)$$
(7.8)

$$=\sum_{i}^{N_c} \sigma^2(d_i) + N_c \sigma^2(d_{cm}) - \frac{2}{N_e} \sum_{i}^{N_c} \left(N_e \left(d_{cm}^e - \overline{d}_{cm} \right) \right) \left(d_{cm}^e - \overline{d}_{cm} \right)$$
(7.9)

$$= \sum_{i}^{N_c} \sigma^2(d_i) + N_c \sigma^2(d_{cm}) - 2N_c \sigma^2(d_{cm})$$
(7.10)

$$= \sum_{i}^{Nc} \sigma^2(d_i) - N_c \sigma(d_{cm}) \tag{7.11}$$

となる。 N_c は総チャンネル数である。以上よりペデスタルの分布の rms の全チャンネル平均 $\sigma^2(d_i)$ およびコモンモードノイズを引いたペデスタルの分布の rms の全チャンネル平均 $\sigma^2(d_{(i)}^{cms})$ には以下の関係がある。

$$\overline{\sigma^2(d_i)} = \frac{1}{N_c} \sum_{i}^{N_c} \sigma^2(d_i)$$
(7.12)

$$= \frac{1}{N_c} \left(\sum_{i}^{N_c} \sigma^2(d_{cms}^{(i)}) + N_c \sigma^2(d_{cm}) \right)$$
(7.13)

$$= \sigma^2(d_{cms}^{(i)}) + \sigma^2(d_{cm})$$
(7.14)

ノイズのチャンネル平均はコモンモードノイズを引いたノイズのチャンネル平均とコモンモードノイズで表される。

小さな値をもつノイズについて全チャンネルの平均を取ることによりノイズレベルの有意な 変化、違いを評価できる。また上式からノーマルモードノイズ、コモンモードノイズの定量的 な評価が行える。なお我々のシステムでは $N_c=64(32 \times 2$ チップ)であり、以後特別な表記が ない限り"コモンモードノイズを引いたペデスタルの分布の rms の 64 チャンネル平均"をノイ ズの定義とする。

ノイズデータの評価

Figure 7.9 に 2000 イベントのペデスタルデータの分布である。コモンモードノイズの大き さは

$$\sqrt{2.434^2 - 2.055} \simeq 1.3$$
 [ADC count]

であり十分小さく抑えられている (0.2p.e. 相当)。ノーマルモードノイズ (2 count 程度) が支配 的であるが、このノーマルモードノイズは環境、ケーブリング、テストベンチのグラウンドラ インの取り扱いによって 3 ~ 5count 程度まで増大する (このときコモンモードノイズの変化は ほとんどない)。現状では2カウントがもっとも良い値であるが、まだノイズ混入のルートが解 明できていない。このノイズ源の解明が課題であるとともに実機導入時のグラウンドラインの 取り扱いには注意が必要である。



Figure 7.9: コモンモードノイズを引く前と後のチャンネルノイズ。上には全 64 チャ ンネルのペデスタル mean の分布、また下にはペデスタル rms の分布を 示した。raw data のノイズ平均は 2.434、common-mode subtraction を したノイズ平均は 2.055 である。

readout clock に起因するノイズ

ここでは VA readout clock "clock_b" がどれだけアナログラインに影響するかを評価した。 "clock_b" はシグナル読み出し中に絶えず出されるものでありこれらが以下のようなノイズを 生じさせると考えられる。

【1】 クロックパルスによるケーブルでのクロストーク (Figure 7.10)

【2】 VA アナログマルチプレクサのチャンネル切り替えによるスイッチングノイズ

【1】については、"clock_b"は差動信号として"clock"とともにケーブルを伝搬しており、こ れら2つの信号は逆位相であるため理想的にはこれらのクロックエッジでアナログラインにの るノイズはキャンセルする。しかし実際はこれらのクロックのドライバIC が極性によって rise time, fall time が違うためキャンセルされないノイズがのることが生じることが考えられる。

【2】はマルチプレクサにおける、チャンネルのスイッチング動作の過渡状態で発生すると考 えられるスパイク波形成分である。

これらを評価するものとして、VA/TA フロントエンドと DAQ module の接続に

• 一般的な 40 極フラットケーブルを用いたとき



Figure 7.10: readout clock によるスパイ クノイズ。差動信号の立ち下がり、立ち上 がりの特性が違うとアナログラインにのる ノイズはキャンセルされない。

20 組の各ツイストペアをシールディングし、さらにその全体に編組シールドをしたケーブルを用いたとき

2種類のノイズ測定を行った。Figure 7.11 に示したのは"clock_b" に対し、その FADC サンプリ ングタイミングを変えていった時のノイズレベルの変化である。フラットケーブルを用いたと きはクロックエッジにおけるノイズの増大が確認された。raw data のノイズと common-mode subtracted データのノイズレベルがほぼ等しく、コモンモードの変化は見られないことからも、 このノイズがノーマルモードノイズであり、クロックエッジによるアナログラインの変動と理 解できる。

一方シールドケーブル用いた測定結果は、どのタイミングでのサンプリングにおいてもノイ ズの変化は見られなかった。

このことは、

- ケーブル伝搬時に読み出しクロックがアナログラインの変動を起こす
- VA アナログマルチプレクサのスイッチングノイズはほとんどない

ことを意味する。なお、編組シールドをしたケーブルを用いることでケーブル上で生じるノイ ズを防げるため、われわれもこのケーブルを用いる。

ノイズについての考察

われわれは 1MHz のクロックで読み出しを行う予定でいる。しかし、前述ように編組シール ドをしたケーブルを用いることでケーブル伝搬時におこるコントロール信号に起因するアナロ グラインへのノイズはほぼ防ぐことができ、読み出しクロックを起因とするノイズに対しては フリーである。これにより、1MHz より高周波数のクロックでもノイズレベルの変動なしに読 み出しができる。先ほどのノイズ測定で述べたが現在われわれの読み出しエレクトロニクスで はノーマルモードノイズが支配的であり、これに対してオーバーサンプリング、すなわち1チャ ンネルの FADC のサンプリング回数を2回、4回と増やしていき、そのデータの平均をとるこ とでノイズレベルが 1/ $\sqrt{2}$,1/2 となることが期待される。

なお、このよう用いるとデータ量が2,4倍となるため、ハードウェアレベルで平均化を行わ なくてはならない。この件に関しては今後の課題として残しておく。

7.4.4 トリガー検出効率

シンチレータトラッカーは検出器自体がニュートリノ標的であり、その読み出しにはセルフ トリガー動作が必要である。よって読み出し系には高いトリガー検出効率が求められるととも



Figure 7.11: readout clock に起因するノイズ。1MHz の readout clock"clock_b" に対 しその FADC サンプリングタイミングを変えていった時のノイズレベル の変化。フラットケーブルを用いた時にはクロックのエッジの後でアナ ログラインの変動によるノイズの増大が確認されるが、シールドケーブ ル使用時にはその影響は見られない。

に TA 出力やシグナルのホールドタイミングの Q 依存性を無くすため、その threshold レベル は極力小さくしたい。

Figure 7.12 はわれわれの読み出し系に対して行ったトリガー検出効率の測定結果である。測定は、外部回路より 1p.e. 相当 (0.08pC) の電荷をもつパルスをフロントエンドボードへの入力 としてシグナル入射を続け、このとき、各 TA threshold 値におけるセルフトリガー動作でのトリガー検出検出効率を測定した。

測定結果

Figure 7.12 に測定結果を示した。横軸は設定 threshold、縦軸はトリガーレートである。このとき TA fast-shaper のパルス高は 75mV 程度であり、threshold を下げていくと、75mV 付近からトリガーシグナルの検出がされはじめ、その後 30mV(0.4p.e. レベル) まで 100%でトリガー検出される。これより低い設定値にするとノイズヒットが支配的となる。 この結果はわれわれの検出器においては十分な性能であるといえる。

チャンネルごとの threshold 値の補正

なお、トリガー検出に関してもう一つの測定を行った。

TA への threshold 設定は全チャンネルー様に行いユニークに一つの値しか選べない。しかし ながら Figure 7.9 に示したようなチャンネル間のペデスタルレベルの相違が存在するのでチャ ンネル間によりトリガー検出効率が異なる。そこで TA の trim-DAC を用いたチャンネル当た りの threshold offset の調整を行う。チャンネルごとにノイズヒットがなくなる threshold 値を 測定した。その結果を Figure 7.13 に示した。全幅で 8mV 程度のばらつきのあったものが 2mV 以内に抑えられる。



Figure 7.12: トリガー検出効率。1p.e. 相当の電荷 (0.08pC, ~ 75ns の fast-shaper の 波高)をもつパルスを入力したときの各 threshold 値でのトリガー検出 効率をプロットした。ノイズヒットが現れるのは 30mV 以下 (0.4p.e.) の threshold 値である。



Figure 7.13: trim-DAC による threshold の補正。trim-DAC で各チャンネルの threshold オフセットを調節する。破線で示したのは補正前の trigger threshold、 実線は補正後のもの。補正によりそのばらつきが小さくなる。

7.4.5 読み出し系のクロストーク

ここでは読み出し系エレクトロニクスに対するクロストークの評価をおこなう。 マルチアノードのクロストーク率は3%であり、読み出し系のエレクトロニクス部分に関し てもそれ以下のクロストーク率であることを要求する。

ここでは読み出し系に付随するクロストーク率を以下の用に見積もった。

測定方法

クロストークが起こる箇所を同定するために、マルチアノードと同じ入力ラインをもちいて VA の1チャンネルにテストチャージを入れ、入力電荷による ADC 出力の変化を全チャンネルに ついて確認した。

またクロストークを起こしたチャンネルの定義は、入力電荷が 35pC(VA のダイナミックレンジ) のときに、分布の mean がペデスタルから 0.5 ADC カウント以上ずれているチャンネル、とした。

測定結果

Figure 7.14 にクロストークを検出した 7 つのチャンネルのプロット、また Table 7.1 にクロス トークを起こした VA チャンネルと PMT チャンネル・TQFP パッケージのピン番号の関係を 示した。

表より、クロストークを起こしているチャンネルを分類すると

【1】アノードの配列で隣接しているチャンネル (PMT20,27,29,36)

【2】VA/TA チップにおいて隣接する入力ピンをもつチャンネル (pin4,pin23)

【3】パルス入力のある VA チャンネルの次に読み出されるチャンネル (VA4)

の3分類しかないことがわかる。

【1】【2】に関してはフロントエンドボード上の信号ラインのパターン間が隣接しているため、【3】に関してはマルチプレクサでシリアル化された"outp, outm"の信号を読み出す際、大きな信号によってその次のチャンネルのベースラインがシフトしてしまうことによると理解できる。

しかし 35pC(450p.e. 相当)の入力にたいしても、クロストークによる ADC 出力は 1p.e. レベ ル以下であり、われわれの検出器においては十分低い、問題ない。



Figure 7.14: 読み出し系のクロストーク。 はパルス入射をしたチャンネルの出力で、 はクロストークシグナルが起こったチャンネル はクロストークを起 こしたチャンネルのうち、アノード配列で入力チャンネルに隣接するチャ ンネルであるものの ADC 出力を示した。

CHIP1			CHIP2		
MAPMT	VA	pin	MAPMT	VA	pin
0	25	27	32	63	33
1	22	24	33	62	32
2	19	21	34	61	31
3	16	18	35	60	30
4	15	17	36	35	5
5	12	14	37	34	4
6	9	11	38	33	3
7	6	8	39	32	2
8	26	28	40	27	29
9	23	25	41	56	26
10	20	22	42	21	23
11	17	19	43	50	20
12	14	16	44	45	15
13	11	13	45	42	12
14	8	10	46	39	9
15	5	7	47	36	6
16	27	29	48	58	28
17	24	26	49	55	25
18	21	23	50	52	22
19	18	20	51	49	19
20	13	15	52	46	16
21	10	12	53	43	13
22	7	9	54	40	10
23	4	6	55	37	7
24	31	33	56	57	27
25	30	32	57	54	24
26	29	31	58	51	21
27	28	30	59	48	18
28	3	5	60	47	17
29	2	4	61	44	14
30	1	3	62	41	11
31	0	2	63	48	8

Table 7.1: クロストークを起こしたチャンネルと PMT チャンネル、VA チャンネル、 TQFP パッケージのピン番号の関係。二重枠で囲った箇所はテストパルス 入れたチャンネルであり、一重線で囲ったところはクロストークシグナル が確認されたチャンネル。PMT チャンネル 28, (VA3), ピンに隣接するの は PMT チャンネル 20,27,29,36 である。 7.4.6 パルスリニアリティについての考察

 R_2

 C_2

CR-RC shaper は基本的にハイパスフィルタとローパス フィルタの合成回路である (Figure 7.15)。簡略化のためス テップパルス

$$\begin{cases} 0 & (t < 0) \\ V_{in} & (t \ge 0) \end{cases}$$
(7.15)

 $^{-\circ}$ の入射を考えると出力波形 V_{out} は

 R_1

$$V_{out}(t) = \frac{V_{in}\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} \left(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2} \right)$$
(7.16)

となり、入力信号の大きさに関わらず、その peaking time は一定になる。(τ_1 および τ_2 はハイパスフィルタ、ローパスフィルタの時定数で $\tau_1 = R_1C_1, \tau_2 = R_1C_2$ である。)

VAの shaper も CR-RCの構成をしており、shaper への入力波形の時定数が短く、ステップ状 に見える限り peaking time は一定だと思われるが、実際はその前段の pre-amplifier の出力波形 の電荷依存性によって shaper の peaking time は変化してしまう可能性がある。我々は peaking time を一定だと思い、パルス高によらず一定時間で信号をホールドしてしまうので、peaking time の時間依存性によりパルスリニアリティを悪くしている可能性がある。

そこで VA slow-shaper に対して、シグナルの大きさによりどの程度 peaking time の変化があるか、またそのリニアリティへの影響はどの程度か、という評価を行った。

測定方法

この評価にあたり VA slow-shaper の出力波形の測 定が必要である。それには test-mode 動作にて、slowshaper のホールドタイミングを変えてスキャンしてい き、各タイミングでの波高を測定する。得られたデー タから、横軸にホールドタイミング、縦軸に各々の分 布の mean をとり、slow-shaper の波形を得た。(Figure 7.16)。

slow-shaper の peaking time の電荷依存性

slow shaper の peaking time の導出においてその出 力波形をフィッティングするが、shaper への入力信号 である pre-amplifier 出力は IC の内部信号であり、そ の波形を確認することができない。そこで適当な関数 型を用意するのは困難なのでピーク波高の導出は次の ように行った。

- 9次巾関数で波形をフィッティング
- 得られたフィッティングパラメータの結果から9 次巾関数のピークを算出



Figure 7.16: slow-shaper の出力波 形。図は9次巾関数で波形をフィッティ ングを行っている。

各入力電荷における波形にたいして行ったフィッティングの結果を Figure 7.17、また peaking time の入力電荷による変化を Figure 7.18 に示した。



Figure 7.17: 入力チャージによる slow-shaper 出力波形の違い。* はフィッティングに より求めたピーク位置。

測定結果は $0 \sim 25 \text{pC}$ の入力電荷の変化に対して peaking time に 200ns 程度の変動がみられる。

考察

前章でも述べたが、ホールド信号によるビームスピル中のノイズヒットを無くすためにわれ われの用いる VA/TA フロントエンドは slow-shaper の peaking time は $\sim 1.2\mu$ s になるように shaper のバイアスを調整してあり、またそのタイミングでホールド信号を送る。実際 Figure 7.18 に示したように、peaking time の平均は $\sim 1.2\mu$ 程度になっている。

しかしこの peaking time は入力電荷量によって ±100ns 程度変動する。この影響を見積もるために

- shaper の peak 波高のパルスリニアリティ(Figure 7.19)
- 固定時間におけるパルス高のリニアリティ(Figure 7.20, Table 7.2)

```
を導出した。
```

その結果は、1.2µs でホールドしたときのゲイン、パルスリニアリティはシグナルピークに おけるものとほぼ同じである。これは shaper の波形がピーク付近数 100ns では十分なだらか



Figure 7.18: peaking time のチャージ依存性。入力電荷の違いによって 200ns 以上の peaking time のずれが生じる。

な変化をするためであり、ゲイン及びパルスリニアリティに対しては±100ns 程度の peaking time のふらつきは影響しない。我々の検出器での使用においては 1.2µs のホールドタイミング で十分な性能、パルスピークと同等の性能が得られることを保証する (Figure ??)。また VA に 対して最適なバイアス設定がなされていることがわかる。

またその他に Table 7.2 のデータを Figure 7.22 にプロットした。われわれの検出器では必要 としないが、> 1.3µs のオフピークではパルスリニアリティの性能が改善することがわかる。な おこのときゲインは下がる。



Figure 7.19: slow-shaper のピークリニアリティ。 は各入力電荷にたいする ADC 値 を表す。目盛りは左側。 は ADC 値のリニアフィッティングに対する ずれの割合。5%のノンリニアリティラインを点線で示した。目盛りは 右側。



99

Hold timing [ns]	Gain [ADC count/pC]	Saturation point
640	77.856 ± 0.03	258 p.e.
704	81.579 ± 0.03	259 p.e.
768	84.562 ± 0.02	262 p.e.
832	86.824 ± 0.03	265 p.e.
896	88.461 ± 0.03	266 p.e.
960	89.546 ± 0.02	267 p.e.
1024	90.112 ± 0.04	270 p.e.
1088	90.303 ± 0.03	271 p.e.
1152	90.093 ± 0.04	272 p.e.
1216	89.490 ± 0.03	277 p.e.
1280	88.640 ± 0.03	283 p.e.
1344	87.569 ± 0.03	288 p.e.
1408	86.211 ± 0.03	294 p.e.
1472	84.684 ± 0.02	300 p.e.
1536	83.065 ± 0.03	307 p.e.
1600	81.190 ± 0.03	315 p.e.
at peak	89.752 ± 0.03	277 p.e.

 Table 7.2: ホールドタイミングの違いによるゲイン、リニアリティの比較。サチュレーションポイントはノンリニアリティ5%の点としてある。最下段に slow-shaper のピークにおける性能も示してあるが、その性能は 1216ns でホールドしたときの性能と同じであることが分かる。



Figure 7.22: ホールドタイミングとゲイン、リニアリティの関係。shaperのpeaking timeを越えると、サチュレーションを起こす入力電荷 (p.e.) はリニアに 改善されている。

7.5 結論

われわれはシンチレータトラッカーの VA/TA フロントエンドボードの読み出し用として DAQ module 開発した。本章ではその DAQ module についての基本構成、またその読み出し 動作について述べた。

さらに VA/TA フロントエンドボードを用いて、本検出器における読み出し用エレクトロニクスの性能評価を行ったが、その結果は

- ノイズレベルは 0.3p.e. 相当 (7p.e. MIP に対して S/N 比は 23)
- コモンモードノイズは小さく抑えられている (0.2p.e. 相当)
- 0.4p.e. 相当のシグナルからトリガー検出可能
- 読み出しボード上でのクロストークは殆どない (450p.e. 相当の電荷入力にたいして 1p.e. 以下のクロストークシグナル)

となる。これらの結果はわれわれのシンチレータトラッカーの読み出し用エレクトロニクスに 対する要請を満たすものである。

Chapter 8

結論

我々は K2K 長基線ニュートリノ振動実験における前置検出器のアップグレード計画として 全感知型のシンチレータトラッカーを導入する。ファインセグメント化され、また不感領域が ないという本検出器の特徴が、CCQE 反応事象に対する高い検出効率・低エネルギーニュート リノ事象の観測を可能にする。本検出器においてニュートリノフラックスの精密測定、スペク トル解析によりニュートリノ振動の確立とともに振動パラメータの精密測定をおこなう。

本論文の研究では、このシンチレータトラッカーの実機導入における課題であった"検出器の 膨大な読み出しチャンネルのシリアル化"という問題に対し、64ch マルチアノード光電子増倍 管 H7546 に対する基礎研究を行い、そのマルチアノード信号のシリアル化を行う VA/TA フロ ントエンドエレクトロニクス、さらに VA/TA フロントエンドの読み出しを行う DAQ module を開発し、本検出器における読み出し系を確立した。

マルチアノードに関しては、ゲイン 5×10^5 において200 p.e. までのパルスリニアリティ(5% ノンリニアリティ)、 ϕ 1.5mm 波長変換ファイバーを使用してもクロストーク率を3%に抑えられることを示し、実機導入へむけての指針を示した。

またこの 64ch マルチアノード出力のシリアル化のためのエレクトロニクス開発においては、 アナログマルチプレクス機能をもつ VA/TA ASIC を用いたフロントエンドボードを開発した。 プロトタイプボードを用いてマルチアノード信号の読み出しの研究、またビームテストによる エネルギー測定テスト等を行い、最終的に実機に導入する

e $^{-}\Omega b\Omega fl qff \Omega \Omega K Ii tfi \Omega t \Phi; \Omega t ^{-}\Omega b\Omega Q \Delta$ Ai =KVo ' gf% 6 9M ' ' 6 % IiR7

Bibliography

- V. M. Lobashev, et al. Direct search for neutrino mass and anomaly in the tritium beta-spectrum: Status of 'troitsk neutrino mass' experiment. *Nucl. Phys. Proc. Suppl.*, Vol. 91, pp. 280–286, 2001.
- [2] K. Assamagan, et al. Upper limit of the muon-neutrino mass and charged pion mass from momentum analysis of a surface muon beam. *Phys. Rev.*, Vol. D53, pp. 6065–6077, 1996.
- [3] R. Barate, et al. An upper limit on the tau neutrino mass from three- and five-prong tau decays. *Eur. Phys. J.*, Vol. C2, pp. 395–406, 1998.
- [4] K. S. Hirata, et al. Experimental study of the atmospheric neutrino flux. *Phys. Lett.*, Vol. B205, p. 416, 1988.
- [5] R. Becker-Szendy, et al. The electron-neutrino and muon-neutrino content of the atmospheric flux. *Phys. Rev.*, Vol. D46, pp. 3720–3724, 1992.
- [6] W. Anthony Mann. New results on atmospheric neutrinos from soudan 2. Nucl. Phys. Proc. Suppl., Vol. 91, pp. 134–140, 2000.
- [7] K. Daum, et al. Determination of the atmospheric neutrino spectra with the frejus detector. WUB-95-03.
- [8] M. Aglietta, et al. Experimental study of atmospheric neutrino flux in the nusex experiment. *Europhys. Lett.*, Vol. 8, pp. 611–614, 1989.
- M. Apollonio, et al. Limits on neutrino oscillations from the chooz experiment. *Phys. Lett.*, Vol. B466, pp. 415–430, 1999.
- [10] First results from kamland: Evidence for reactor anti- neutrino disappearance. 2002.
- [11] T. Maruyama. First observation of accelerator origin neutrino beam after passing through 250km of earth. *Ph.D thesis*, 2000.
- [12] T. Inagaki. Measurement of the dissappearance of muon neutrion in 250 km long base line experiment. Ph.D thesis, 2001.
- [13] M. H. Ahn, et al. Indications of neutrino oscillation in a 250-km long-baseline experiment. 2002.

- [14] S. H. Ahn, et al. Detection of accelerator produced neutrinos at a distance of 250-km. *Phys. Lett.*, Vol. B511, pp. 178–184, 2001.
- [15] 加藤一成. K2k 長基線ニュートリノ振動実験における液体シンチレータ飛跡検出器の開発 とその基本特性および *p*/π 識別能力の評価. 修士論文, 京都大学大学院理学研究科, 2001.
- [16] 前坂比呂和. K2k 長基線ニュートリノ振動実験における全感知型シンチレータ飛跡検出器 のバックグラウンドと長期安定性の測定.修士論文,京都大学大学院理学研究科,2002.
- [17] 長谷川雅也. K2k 長基線ニュートリノ振動実験における全感知型シンチレータ飛跡検出器 の基本性能の評価及びゲインモニターシステムの開発. 修士論文, 京都大学大学院理学研 究科, 2003.
- [18] W. R. Leo. Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer-Verlag, 1994.

謝辞

本論文の執筆、またそれまでの研究において多くの方のお力添えがありました。言葉になら ない謝意の念に満たされております。

西川 公一郎教授にはわたしの指導教官として多くのことを教え導いて頂くとともに K2K と いうすばらしい実験に参加させていただく機会を頂きました。また中家 剛助教授にはその助言 から多くを学び、研究の指針を与えて頂きました。

本検出器におけるエレクトロニクス開発においては田中 真伸助教授の助言がなければ為し得 なかったことが数多くあります、感謝しております。またその開発において吉田 誠さまとは多 くの仕事を共にさせていただきましたが、ご迷惑をかけたことが多かったのではないでしょう か。村上 武さまにも誠に多くの御協力をしていただきました。

当ニュートリノグループにおきましても多くの方に謝意を述べなくてはなりません。加藤 一 成さまにはある意味で生き方の参考にさせていただくことが数多くありました。前坂 比呂和さ まには本検出器のボスとして奮闘していただいております。わたしも身を粉にしてがんばらせ ていただきますのでお体にはお気をつけください。長谷川 雅也さまとは、同期として共に数多 くのことを行ってきたとともにわたしの心の支えとなっております。上田 俊輔さま、佐々木 通 さま、林 和彦さま、森田 太智さまには実験の忙しい時期に、わたしが修士論文執筆のために 一線を退いてしまいご迷惑かけたのではないでしょうか。来年は大変でしょうが、がんばって ください。

思いもよらず長居することになってしまった KEK でも多くの方にお世話になっております。 小林 隆助教授、早戸 良成助手、市川(近藤)温子助手、岩下 大器さま、横山 広美さまをはじ め多くの方々に生活面でお世話になるとともに、このような輩をあたたかく受け入れていただ きました。感謝しております。

また京都大学高エネルギー物理学研究室の皆様方にも非常にお世話になっております。 最後にわたしの研究生活をあたたかく見守っていただいている両親に感謝いたします。

2003年1月山本真平
List of Figures

1.1	sub-GeV, multi-GeV 領域での e および µ-like の 1-ring 事象サンプルの zenith	
	angle distribution	12
1.2	上向き μ 事象の zenith angle distribution	12
1.3	90%C.L. における振動パラメータの許容領域	13
2.1	K2K 実験	15
2.2	$K2K$ 実験の $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{X}$ 振動に対する感度	16
2.3	ニュートリノエネルギー再構成	16
2.4	CCQE反応	17
2.5	non-QE 反応	17
2.6	ニュートリノビームライン	18
2.7	電磁ホーンシステム	19
2.8	SK におけるニュートリノフラックス	19
2.9	π 中間子モニターの概要	20
2.10	Super-Kamiokande と前置検出器でのニュートリノフラックス比	20
2.11	ミューオンモニターとビーム安定性...........................	20
2.12	K2K前置検出器	21
2.13	Super-Kamiokande 概略図	23
2.14	SciFi 2 トラックイベント	24
2.15	$1\mathrm{kt}$ 検出器で測定された $p_\mu, heta_\mu,E_ u^{rec}$ 分布 \dots	24
2.16	SciFi 検出器で測定された $p_{\mu}, \theta_{\mu}, E_{\nu}^{rec}$ 分布	25
2.17	前置検出器でのニュートリノフラックス	25
2.18	Super-Kamiokande における reconstructed E_{ν} 分布	26
2.19	K2K 実験による振動パラメータ許容領域	27
3.1	振動なしのときに対する振動ありのときのニュートリノ毎測数の比(モンテカル	
0.1		30
3.2	シンチレータトラッカーの概要とインストール箇所	31
0.1		-
4.1	シンチレータトラッカーにおけるシグナル読み出し部の構成	34
5.1	H7546の特性	38
5.2	テストセットアップの構成.................................	40
5.3	LED 発光の安定性	41
5.4	H7546 のゲイン曲線	42
5.5	H7546 のダークカレント	42
5.6	2-inch PMT による入射光量のモニター	43

5.7	H7546のパルスリニアリティ	44
5.8	H7546におけるピクセル当たりのアノードユニフォーミティ	45
5.9	クロストーク率測定におけるマルチアノードのピクセルスキャン	46
5.10	H7546 におけるチャンネル間クロストーク (<i>d</i> 0.7 WLS fiber 使用時)	47
5.11	H7546 におけるチャンネル間クロストーク (ϕ 1.0 WLS fiber 使用)	47
5.12	パルス入射位置がピクセル中心からずれた時の周辺チャンネルのADC出力	48
5.13		50
5.14	T_{7546} のチャンネルコニフォーミティ	51
5 15	117546 の時間公報能	50
0.10		52
6.1	VA32_HDR11+TA32CG	56
6.2	VA/TA の基本構成	57
6.3	VA/TA 読み出しの基本動作	59
6.4	VA slow shaper の出力	60
6.5	2チップを用いた読み出しシーケンス	62
6.6	$VA / TA J \Pi F a J \Pi D F T F F F F F F F F F F F F F F F F F$	6 <u>3</u>
6.7	VAのチャンネル問クロストーク	65
6.8	MO(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)	66
6.0	$DO DO DO DO DO DO NEODO VA O VIP NFE \dots \dots$	67
0.9 6 10		60
0.10		09
0.11	KEK-PS II ヒームフィノ	70
0.12		(1
6.13		72
6.14	VA による読み出しと charge sensitive ADC による読み出しの比較	73
6.15		74
6.16		74
6.17	ビームテストにて観測されたコモンモードノイズ	75
6.18	コモンモードを引く前と後のシグナル分布	75
6.19	コモンモードノイズに対するフィルタリング	76
6.20	開発したフロントエンドボードの写真	77
F 1		70
7.1		79
7.2		80
7.3		81
7.4	読み出しエレクトロニクスのフロックタイアクラム	82
7.5	normal-mode の動作	83
7.6	test-mode の動作	84
7.7	パルスリニアリティの測定結果	85
7.8	VA のチャンネルゲインユニフォーミティ	87
7.9	コモンモードノイズを引く前と後のチャンネルノイズ	89
7.10	readout clock によるスパイクノイズ	90
7.11	readout clock に起因するノイズ	91
7.12	トリガー検出効率....................................	92
7.13	trim-DAC による threshold の補正	92
7.14	読み出し系のクロストーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
		0.0
7.15	CR-RC shaper	96

7.16	slow-shaperの出力波形	96
7.17	入力チャージによる slow-shaper 出力波形の違い。* はフィッティングにより求	
	めたピーク位置。	97
7.18	peaking time のチャージ依存性	98
7.19	slow-shaper $\mathcal{O}\mathcal{C}$ - $\mathcal{O}\mathcal{V}$	98
7.20	ホールドタイミングの違いによるゲイン、リニアリティの変化	99
7.21	slow-shaper における 1.2µs でパルスホールドしたときとピークの波高の比較 .	99
7.22	ホールドタイミングとゲイン、リニアリティの関係	100

List of Tables

$\begin{array}{c} 1.1 \\ 1.2 \end{array}$	ニュートリノ質量	8 11
$2.1 \\ 2.2$	Neutrino Interactionトリノ事象数と振動がないときの期待値	17 23
3.1	検出器の基本特性および性能...............................	31
$5.1 \\ 5.2 \\ 5.3 \\ 5.4$	H7546の特性リスト マルチアノードのパルスリニアリティ測定のまとめ H7546のクロストーク測定の結果 クロストークの High Voltage 依存性の測定結果	37 43 48 49
$6.1 \\ 6.2 \\ 6.3$	VA32_HDR11+TA32CG specification	56 58 58
7.1 7.2	クロストークを起こしたチャンネルと PMT チャンネル、VA チャンネル、TQFP パッケージのピン番号の関係................................ ホールドタイミングの違いによるゲイン、リニアリティの差.........	95 100